

Optická emisní spektrometrie laserem buzeného plazmatu - LIBS

Laser Induced Breakdown Spectrometry

LIPS - Laser Induced Plasma Spectrometry

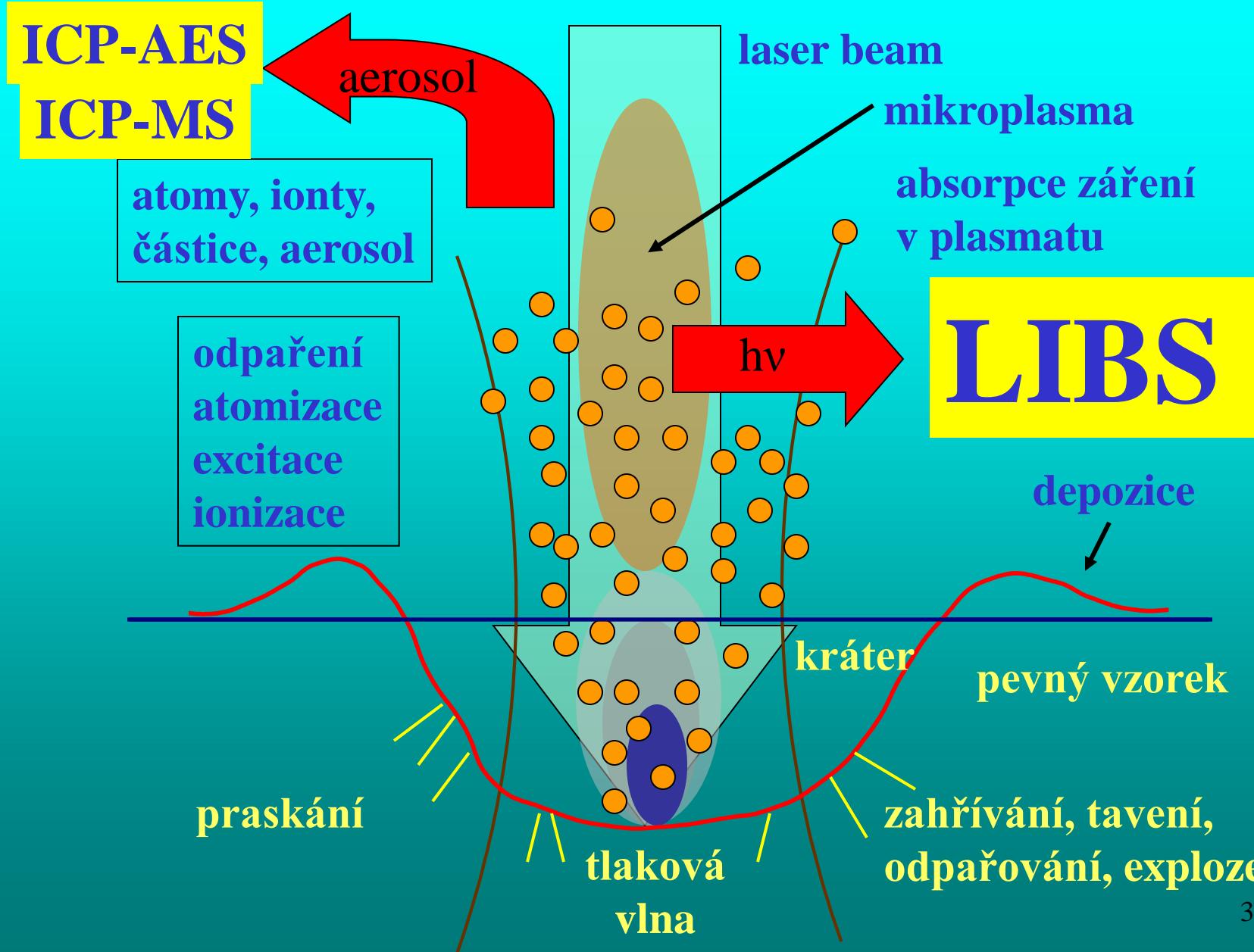
(LAS – laser ablation spectrometry)

(LSS – laser spark spectrometry)

Základní princip:

- interakce vzorku s laserovým paprskem o vysoké hustotě záření ($\sim 0.1 - 10 \text{ GWcm}^{-2}$ - laserová ablace), pulzní lasery
- prudký ohřev povrchu vzorku, odpaření uvolnění materiálu ve formě aerosolu a par
- vznik mikroplazmatu, emise elektromagnetického záření
- detekce záření (spektrometrie s časovým rozlišením)

Interakce laserový paprsek – pevný vzorek



Nejčastěji používané typy pulzních laserů:

Pevnolátkové:

nanosekundové pulzy

- Nd:YAG - 1064 nm základní vlnová délka
- 532 nm druhá harmonická frekvence
- 266 nm čtvrtá harmonická frekvence

Ti-safírový – femtosekundové pulzy

Excimerové:

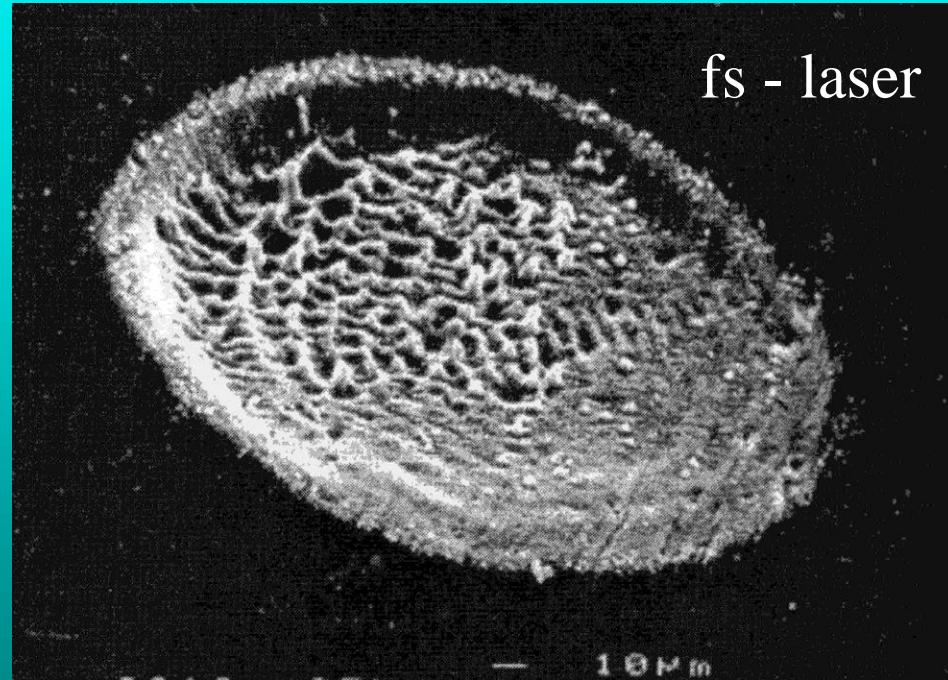
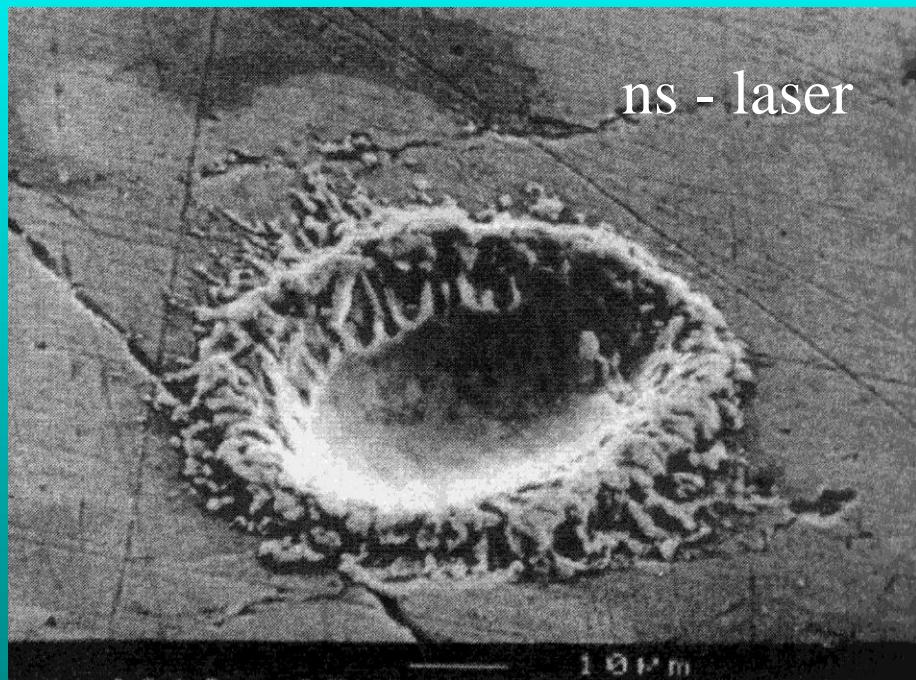
193 nm ArF

248 nm KrF

308 nm XeCl

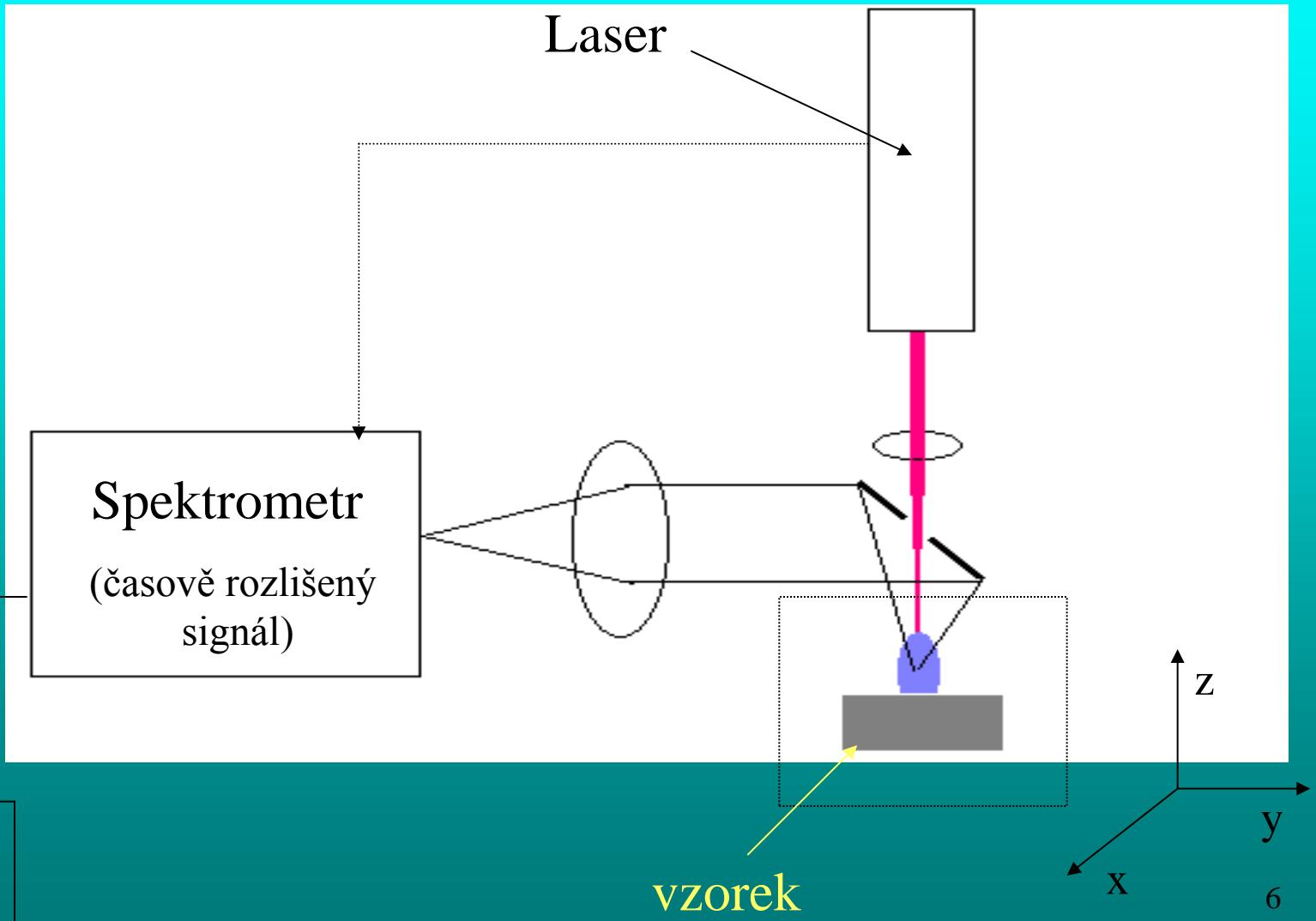
Vliv délky pulsu

- při kratších pulsech snižování tavení a napařování materiálu, minimalizace frakcionace selektivním vypařováním z taveniny
- menší energie mikroplazmatu – snižování atomizace materiálu ablatovaného ze vzorku

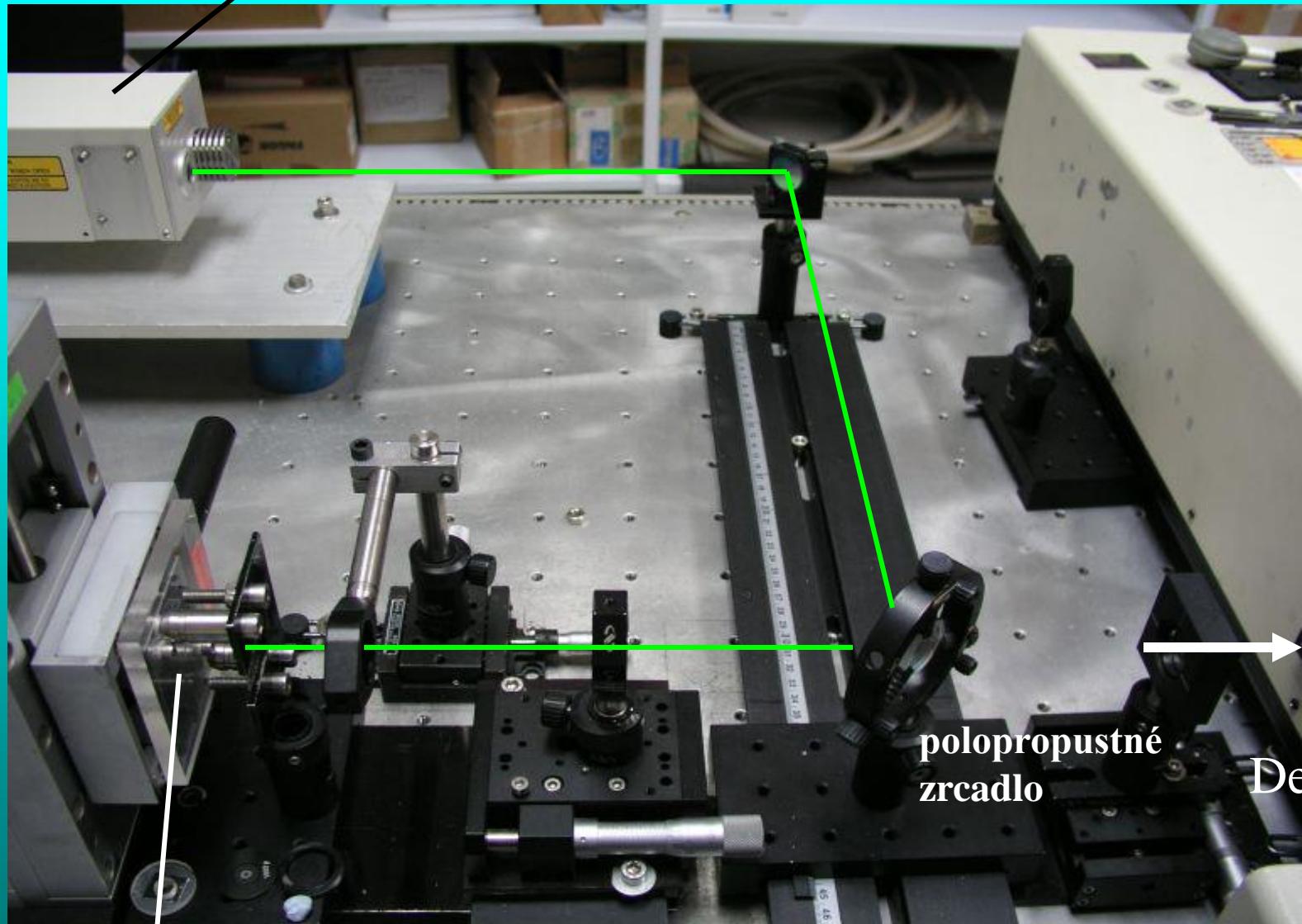


K. Niemax, Laser ablation – reflection on a very complex technique for solid sampling,
Fresenius J. Anal. Chem. (2001) 370:332-340)

Uspořádání s polopropustným zrcadlem (zrcadlem s otvorem)



Laser

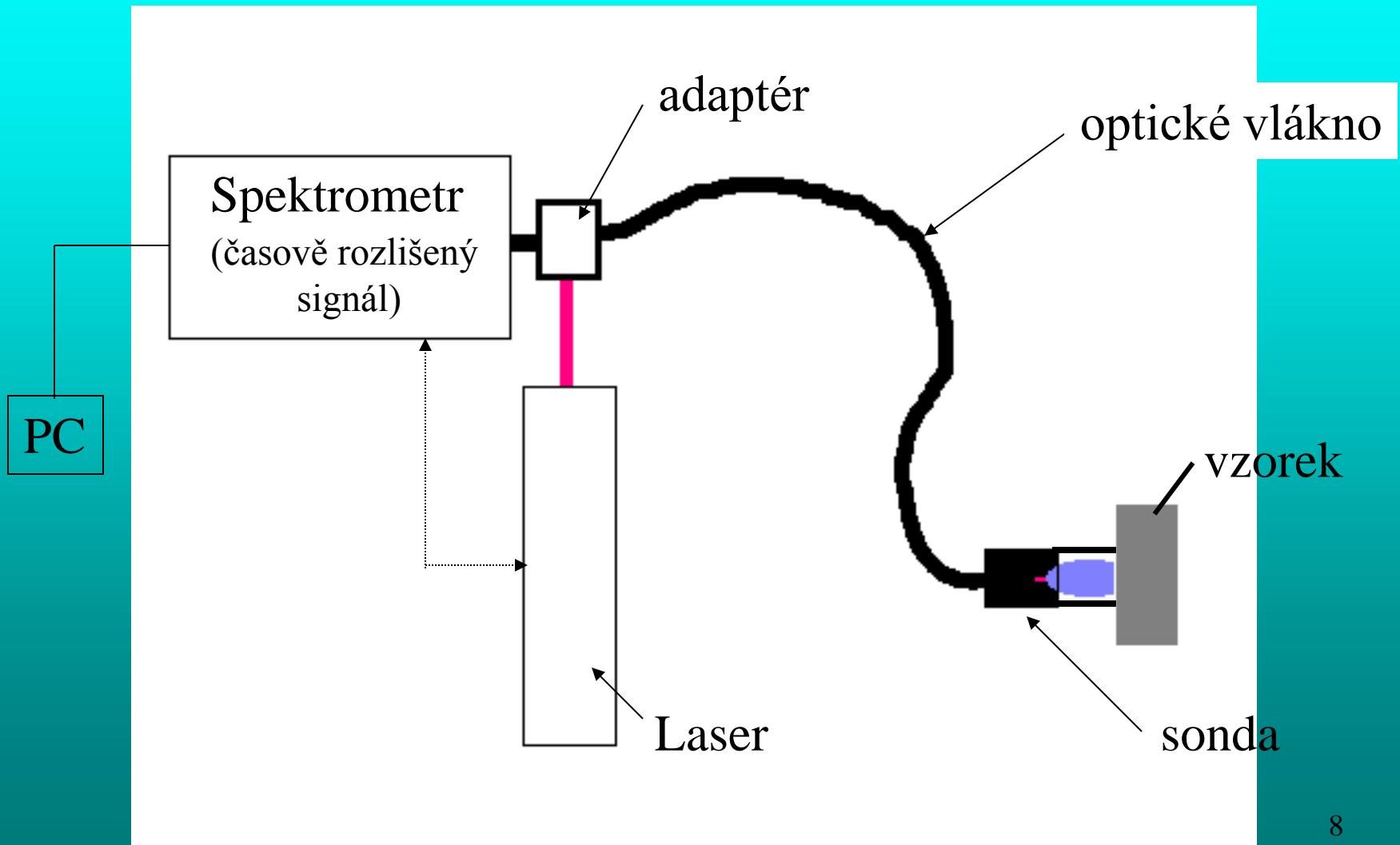


Vzorek

7

Uspořádání s optickými vlákny

přenosná mobilní zařízení – in-situ monitoring



Field-Portable LIBS Analyzer

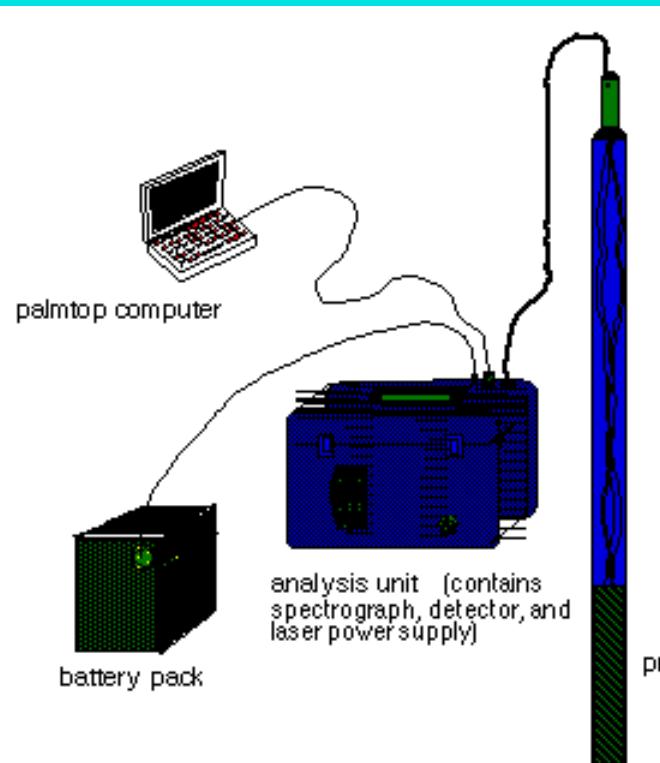
Limity detekce (kovy v půdě)

Be 10 ppm

Ba 320 ppm

Pb 156 ppm

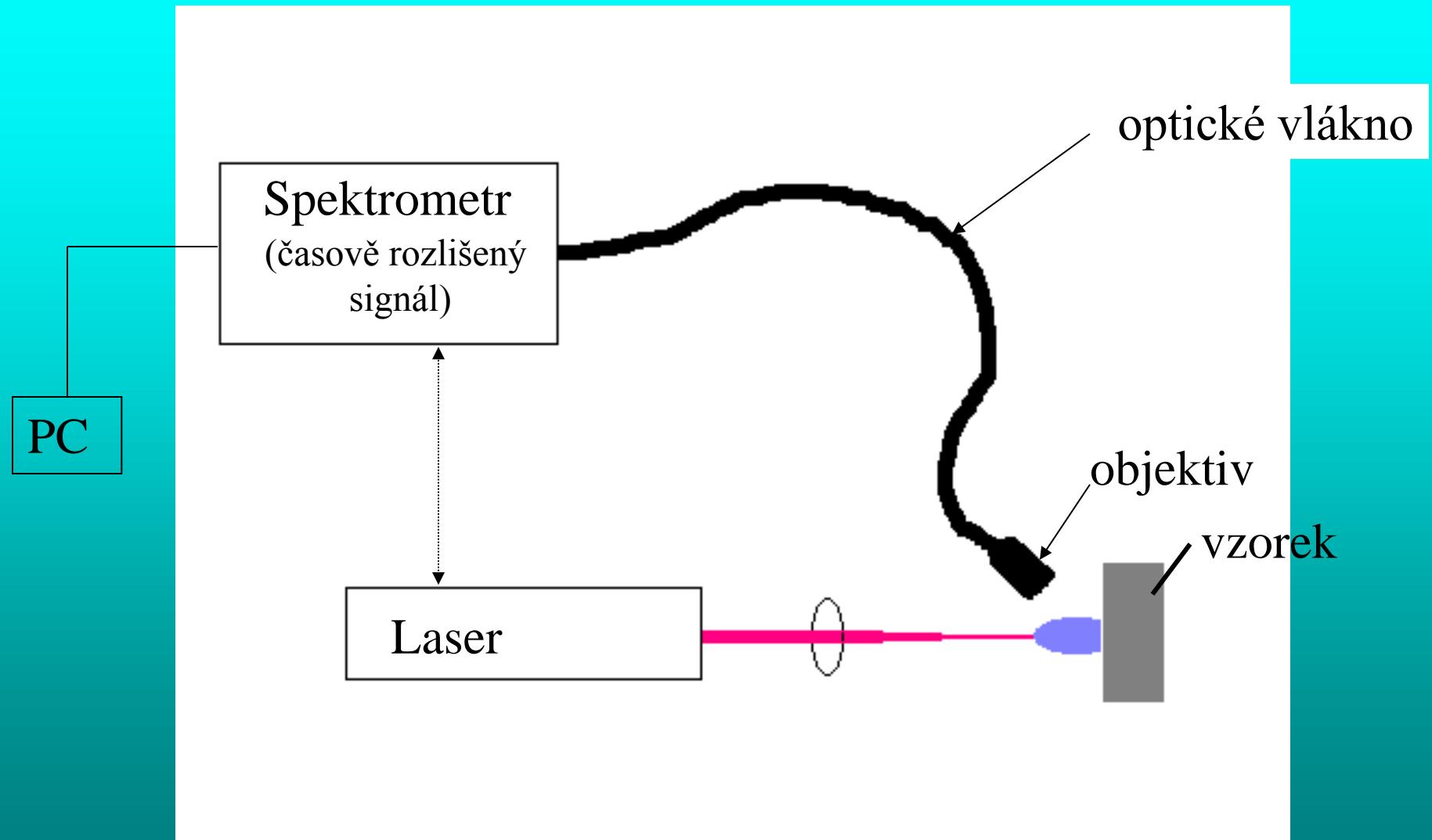
Cr 85 ppm



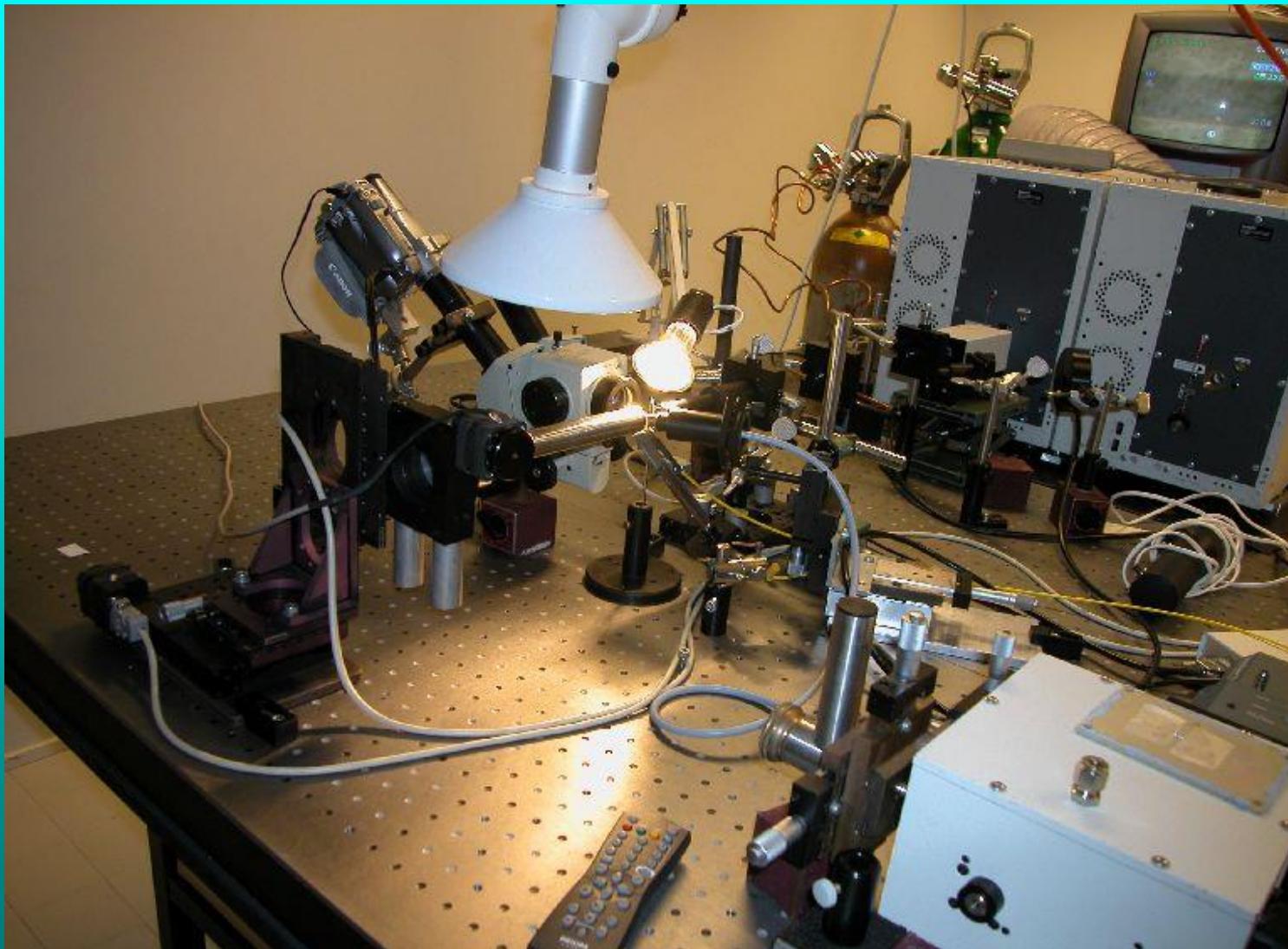
Detektor min



Detekce s využitím optického vlákna



Detekce s využitím optického vlákna



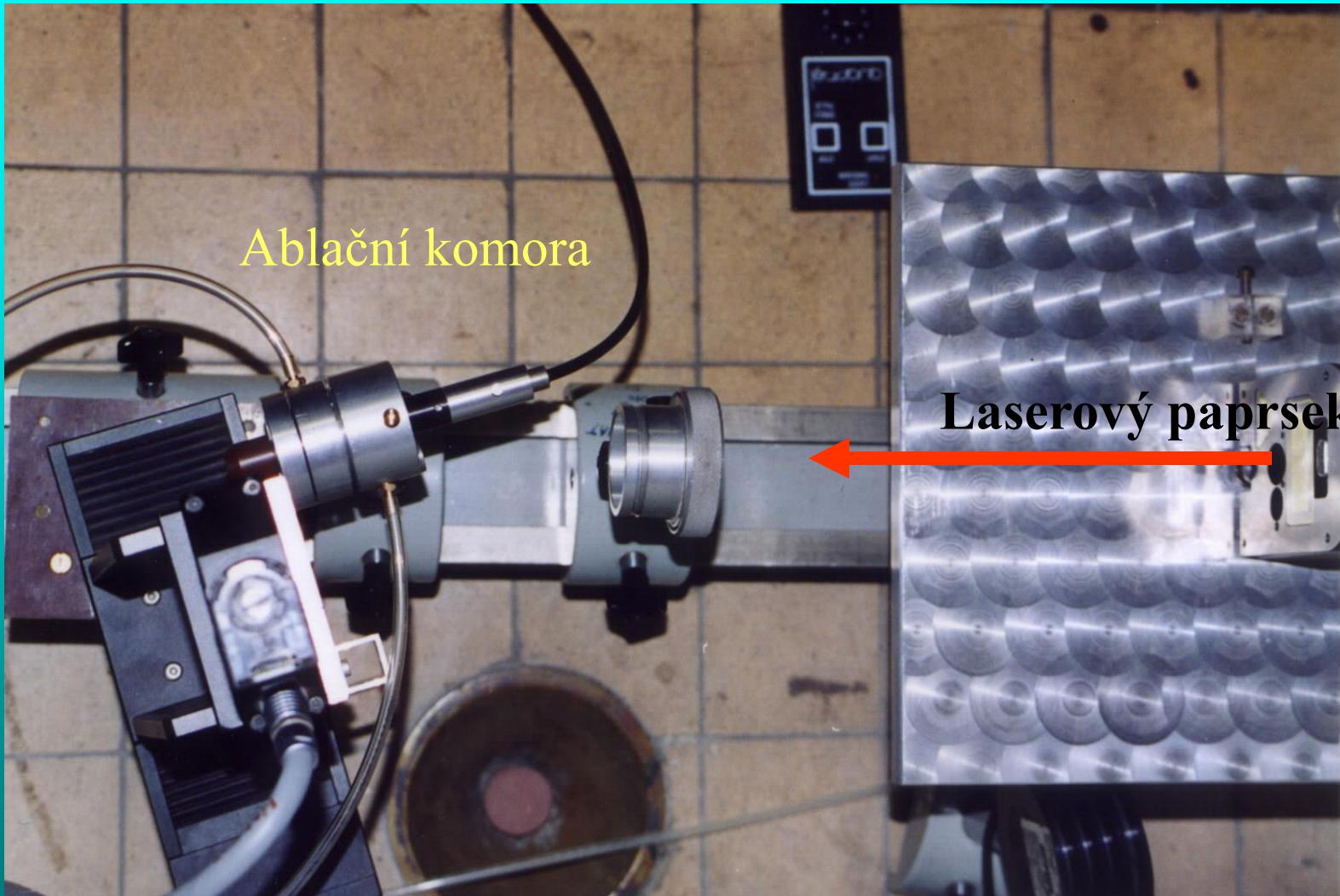
Detekce s využitím optického vlákna

ICP

Ablační komora

Ar

Laserový paprsek



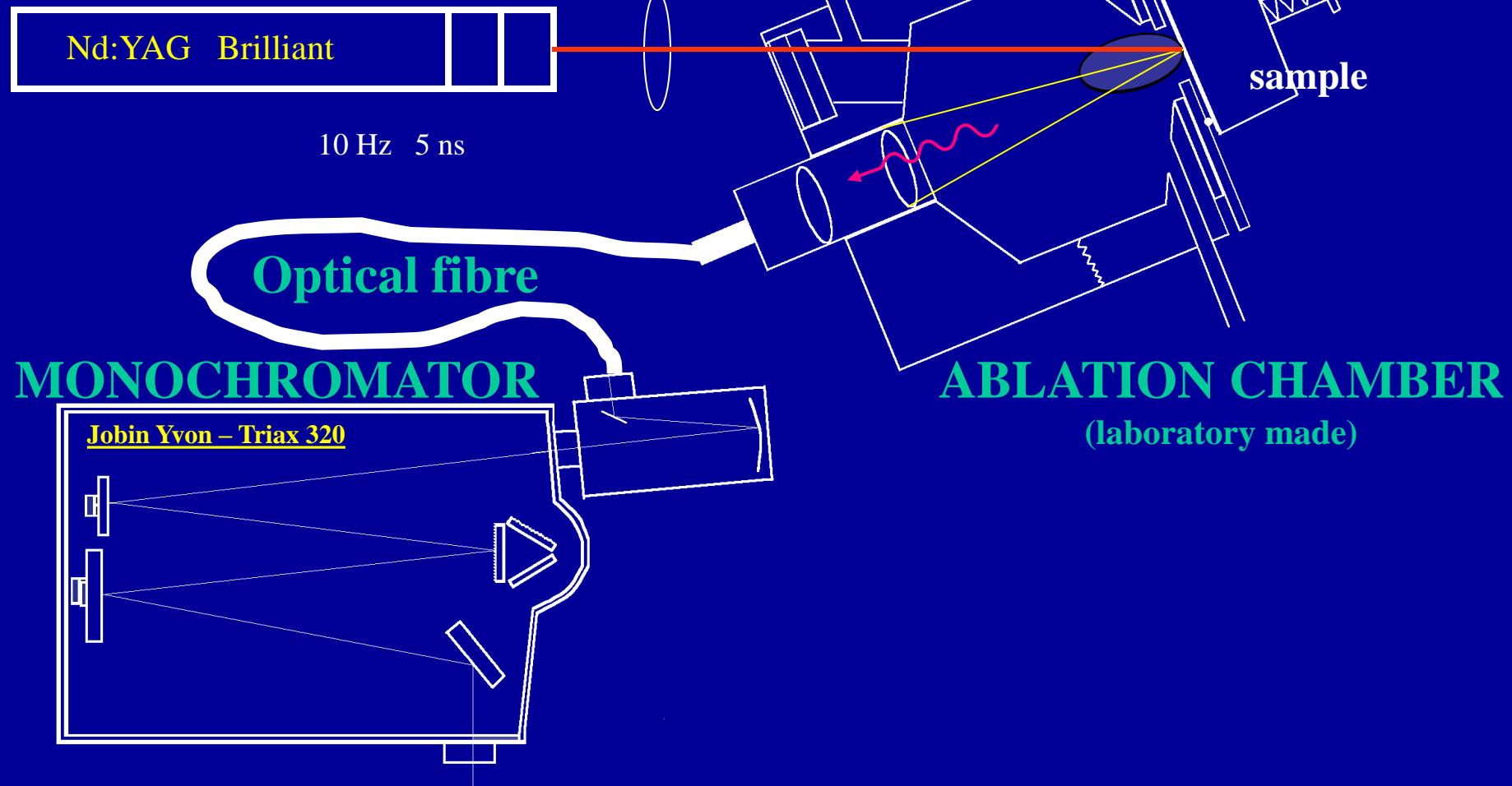
LASER

1064 nm 266 nm

Nd:YAG Brilliant

10 Hz 5 ns

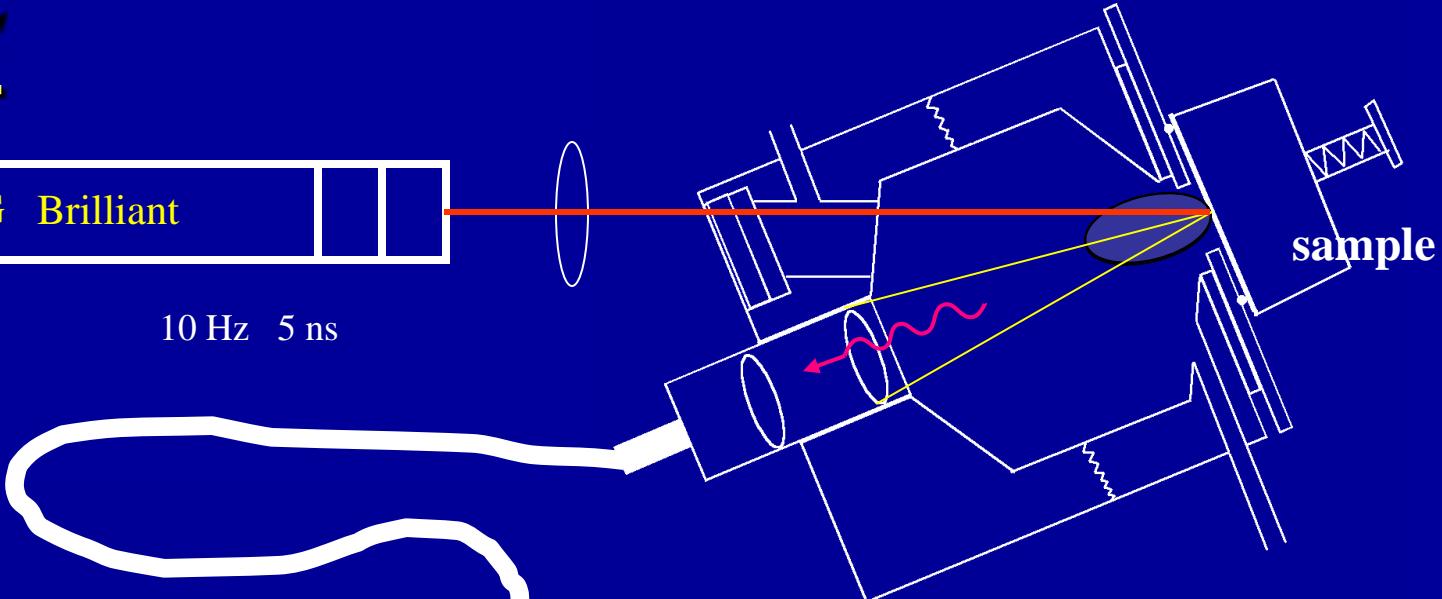
LIBS



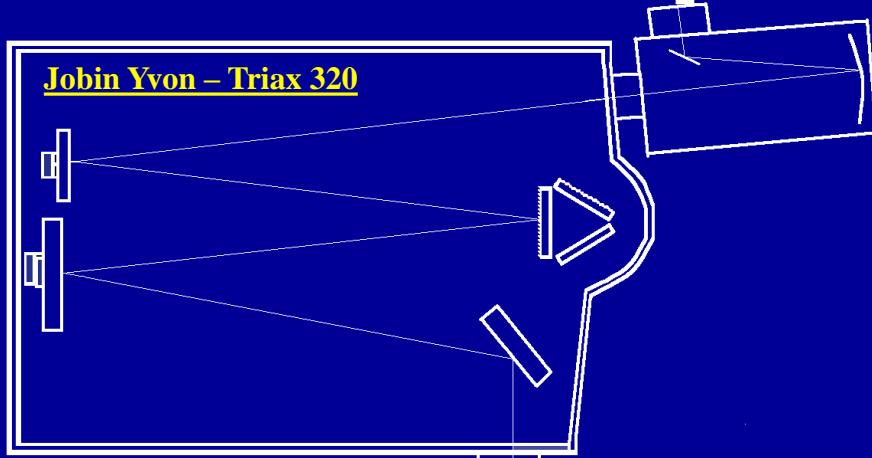
LIBS

Nd:YAG Brilliant

10 Hz 5 ns



Jobin Yvon – Triax 320



PMT Hamamatsu R928

Gated Socket Assembly
Hamamatsu C1392

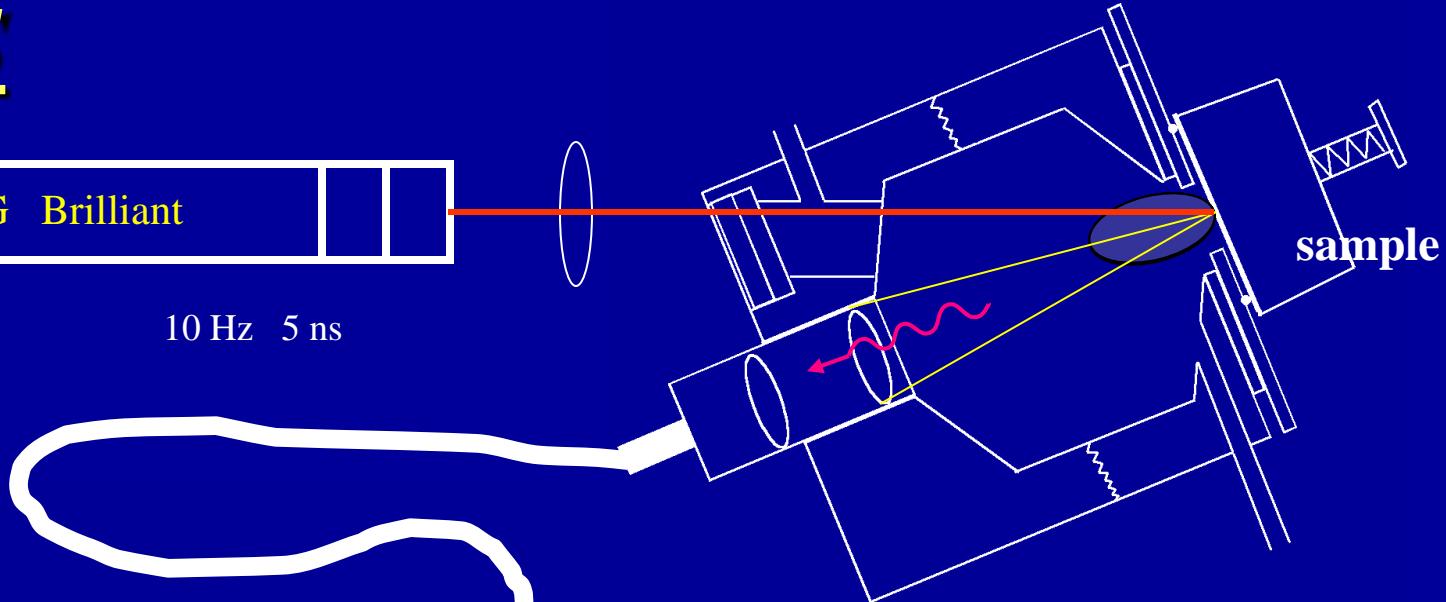
Control unit
(laboratory made)

Synchronization – Q switch

LIBS

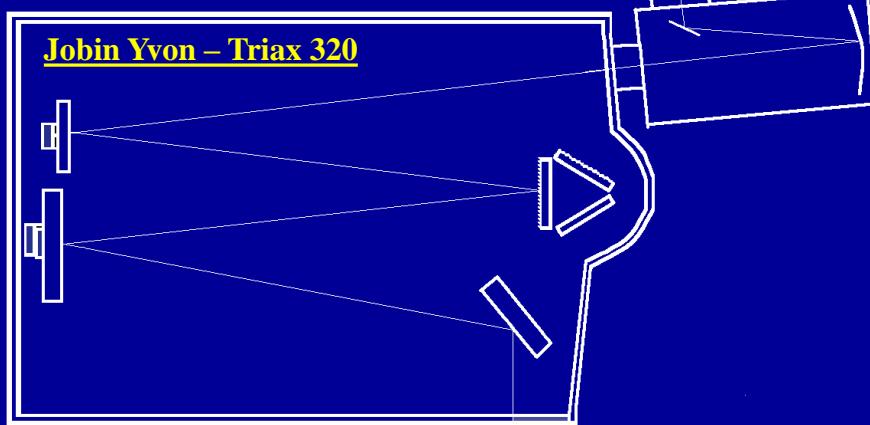
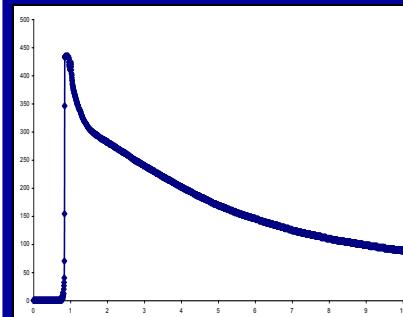
Nd:YAG Brilliant

10 Hz 5 ns



OSCILLOSCOPE

Tektronix TDS 1012



PMT Hamamatsu R928

Gated Socket Assembly
Hamamatsu C1392

Control unit
(laboratory made)

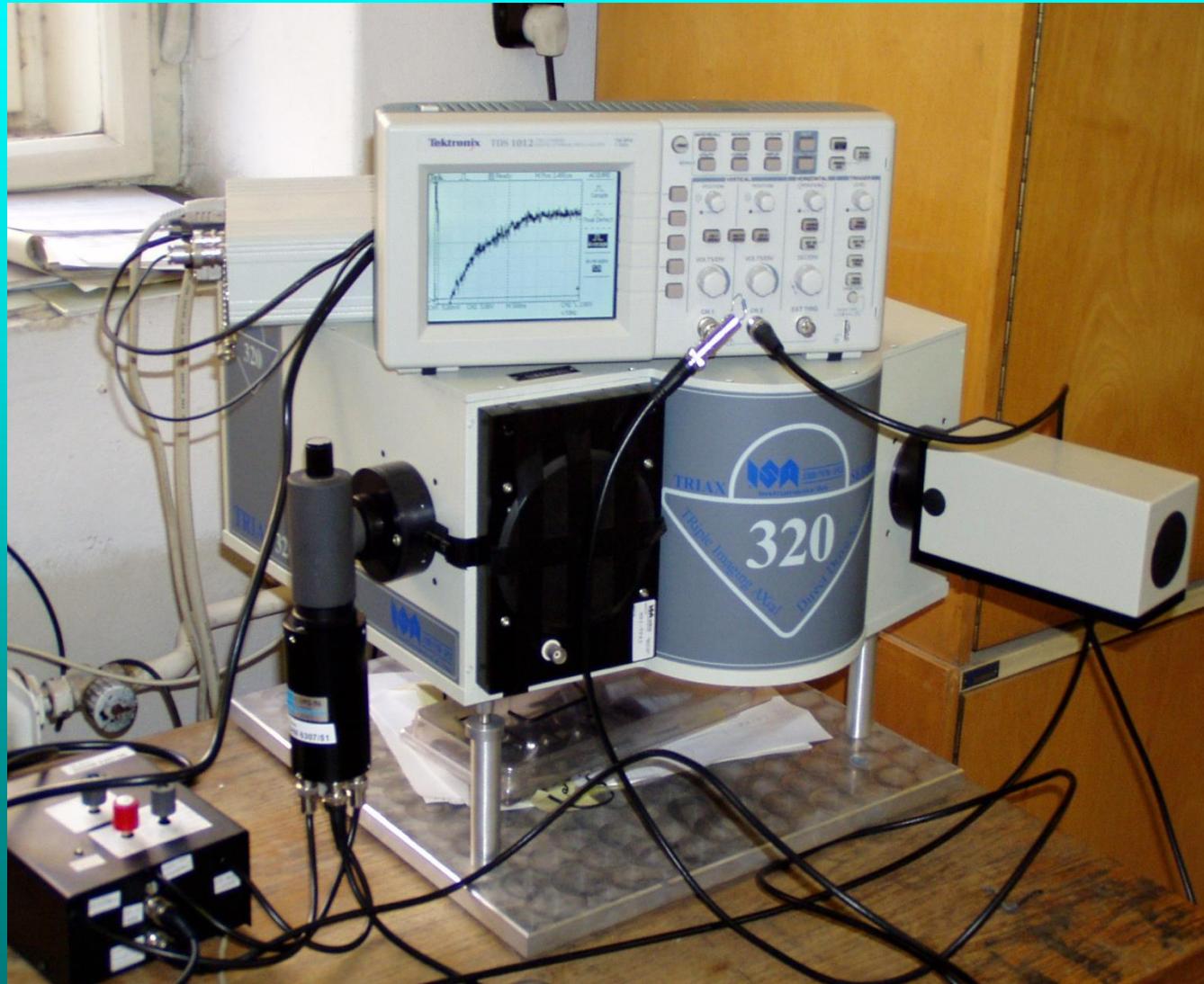
Synchronization – Q switch

Synchronization

DELAY TIME

10

Instrumentace: Monochromátor TRIAX 320 (Czerny – Turner 320 mm),
3 mřížky (1200, 2400 a 3600 vypů/mm), vstupní a výstupní štěrbina 0-2mm



Fotonásobič
Hamamatsu R928

Klíčovací patice
C1392 – 56 (off-typ)

Přídavná elektronika
řízení fotonásobiče
impulsem Q – switch
délka okna 5 až 25 μ s
zpoždění 50 ns - 10 μ s
zdroje napětí pro patice
a fotonásobič

Osciloskop TDS 1012
propojení přes sběrnici
RS-232C s PC
software Scope 6.1

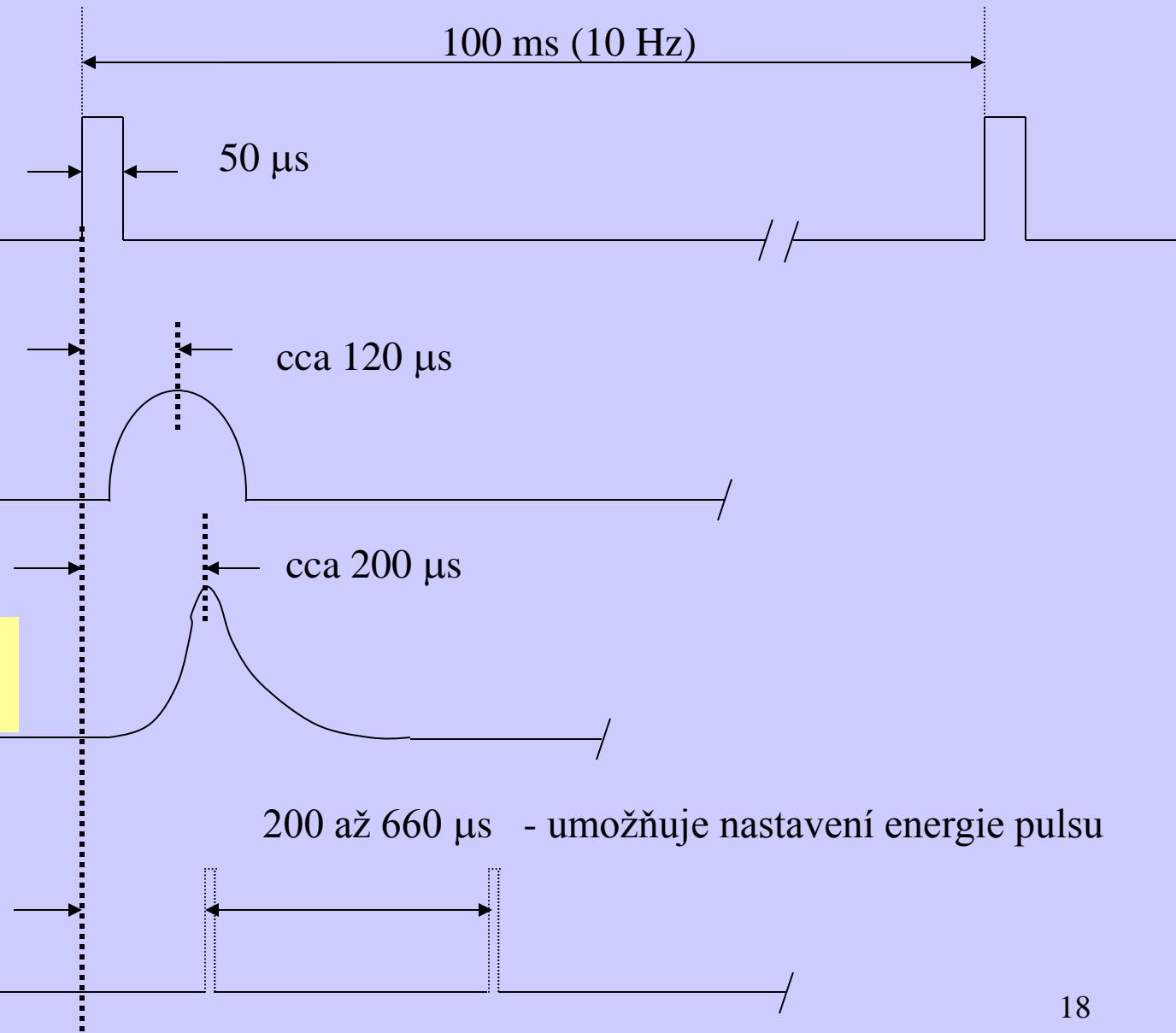
Časový režim laseru

řídící puls -
Xenonová výbojka

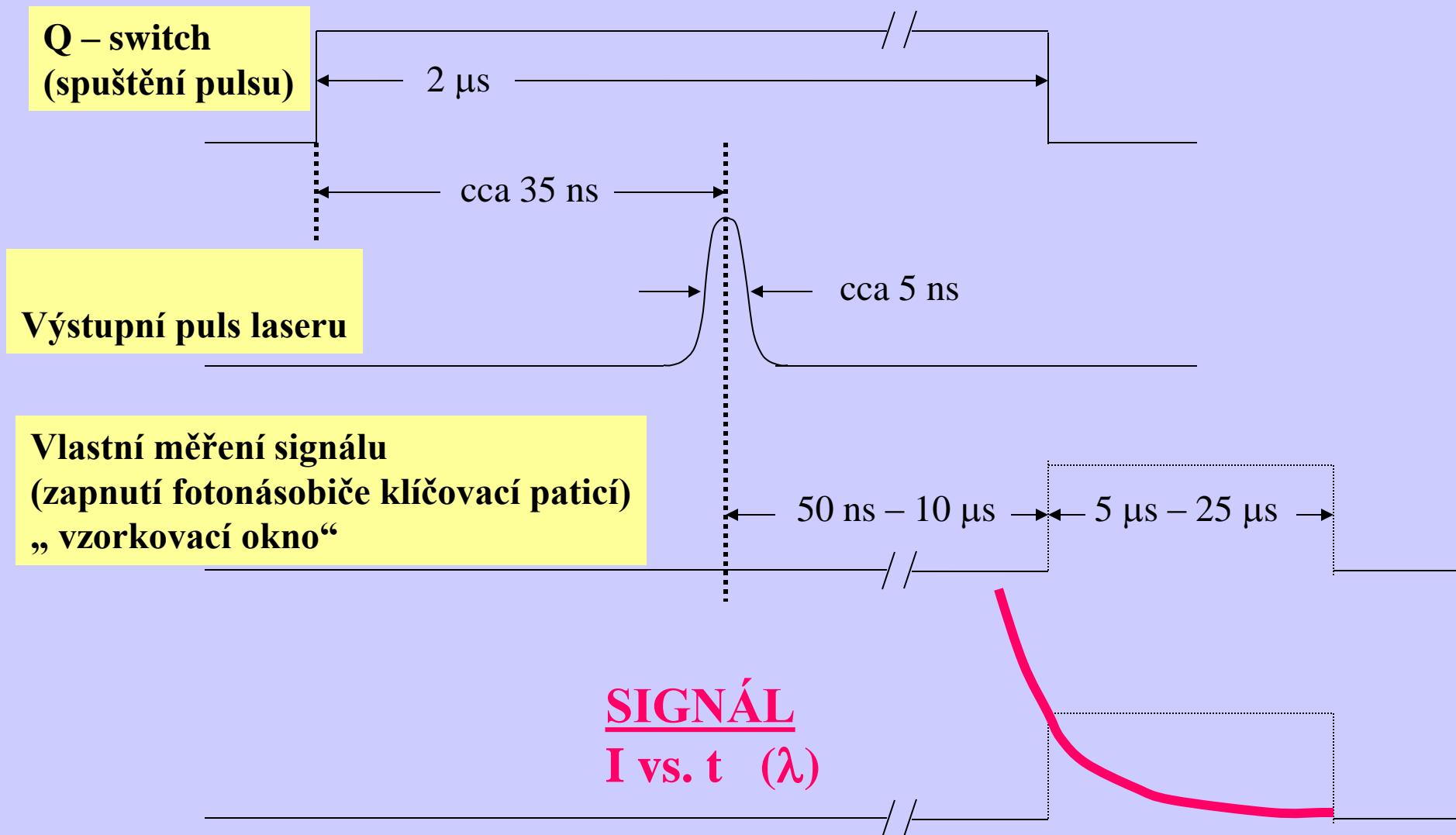
elektrický puls
Xenonová výbojka

průběh fluorescence
Neodymu

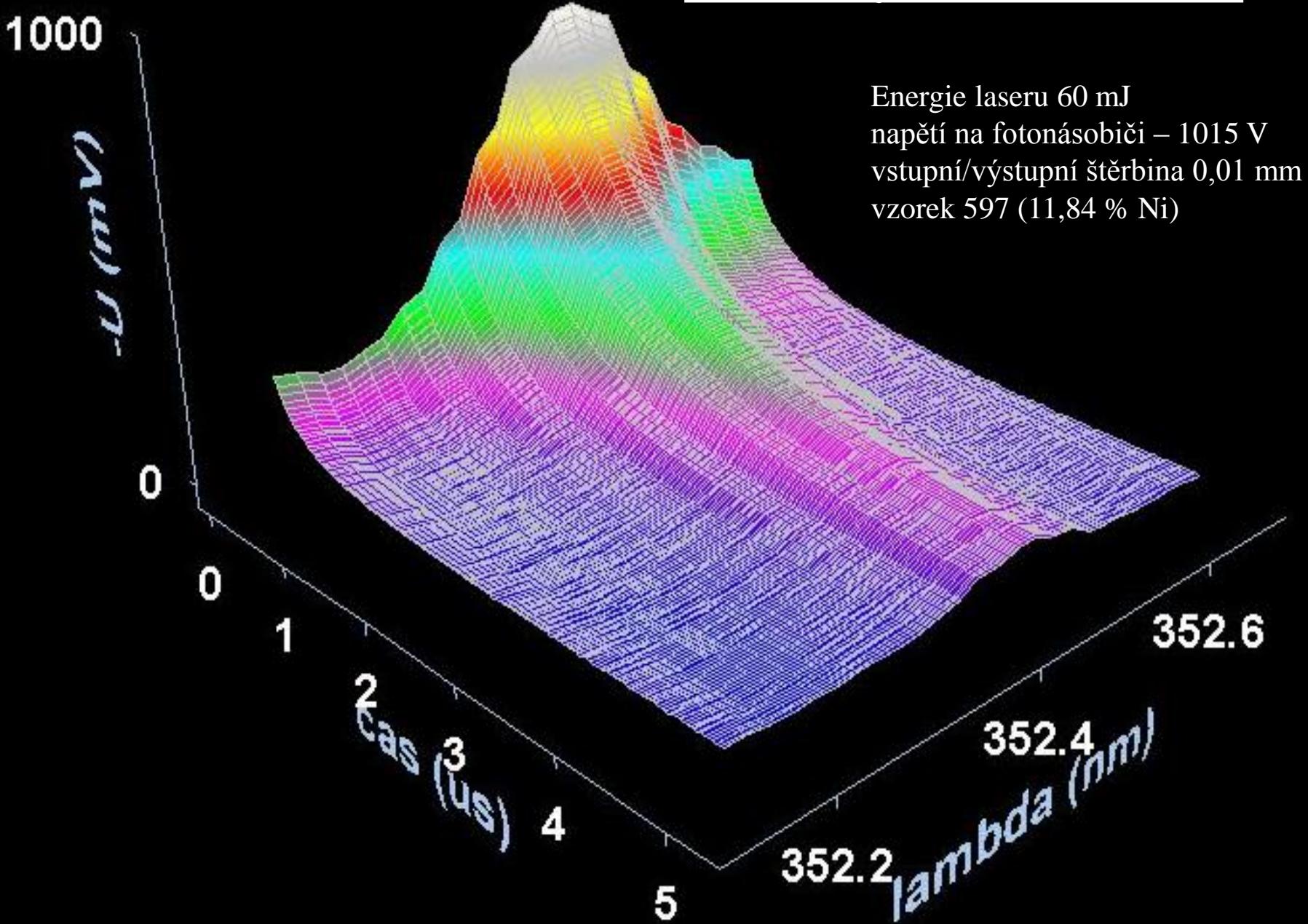
Q – switch
(spuštění pulsu)



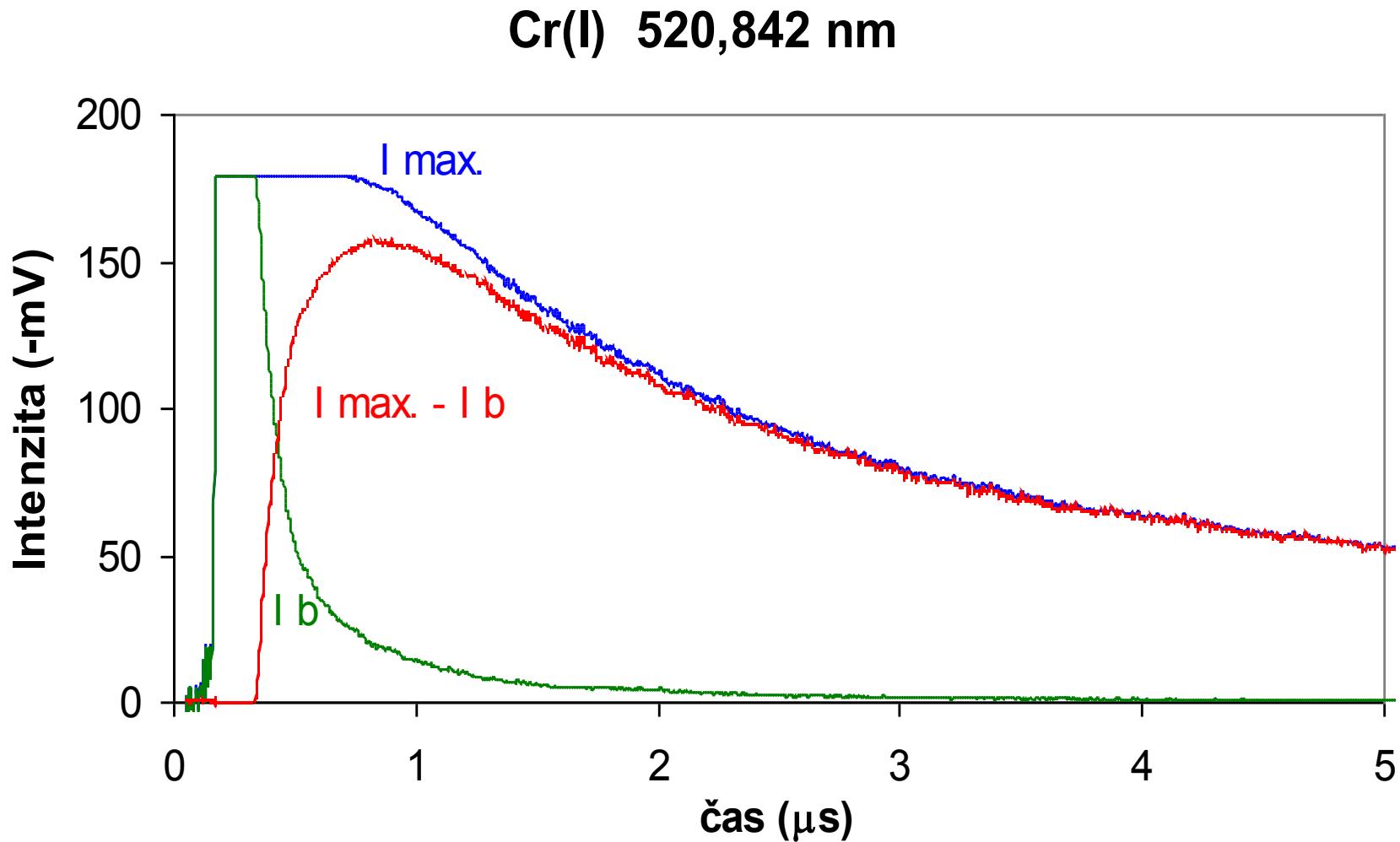
Časový režim měření



Profil čáry Ni(I) 352,454 nm



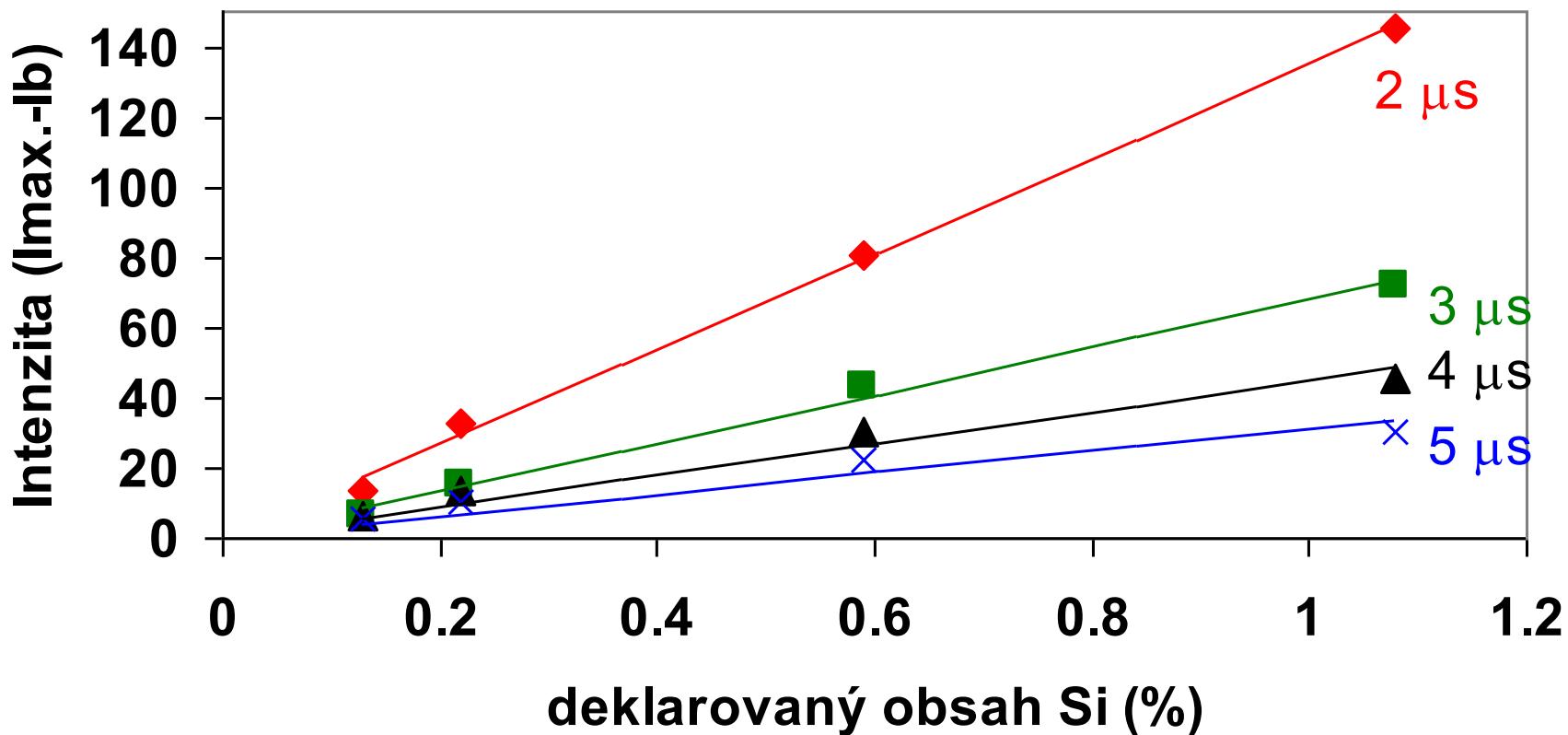
Průběh signálu 50 ns až 5 μ s po pulsu laseru v maximu čáry Cr I - 520,84 nm ($I_{\max.}$), na pozadí při 520,50 nm (I_b) a rozdíl signálů v maximu a na pozadí ($I_{\max.} - I_b$).
Měření vzorku 558 (27,98 % Cr), průměrný signál po 128 pulsech laseru.



Kalibrační křivka pro Si

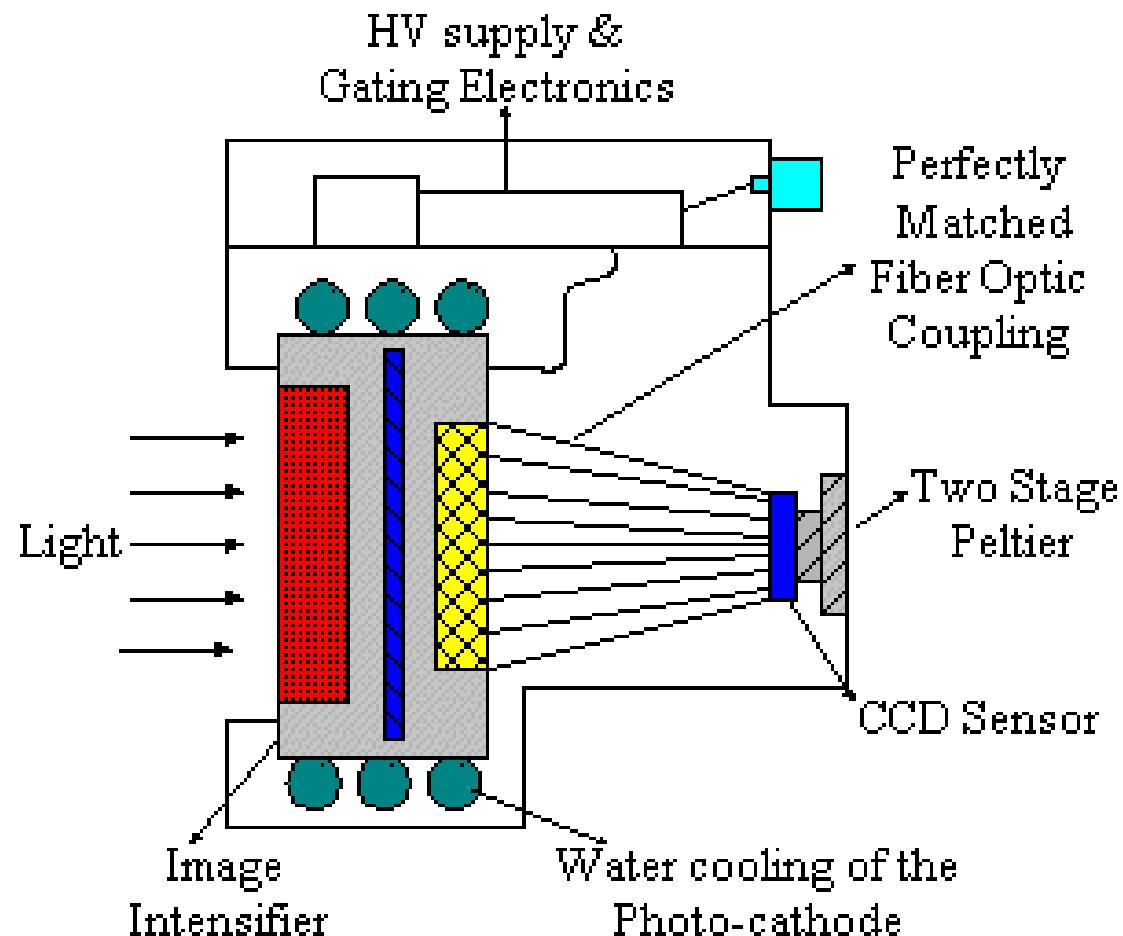
Si(I) 288,158 nm odečet pozadí 288,358nm ($I_{\max} - I_b$).
průměrování 128 pulsů laseru
3 měření v různých místech vzorku

Si 288,158 nm



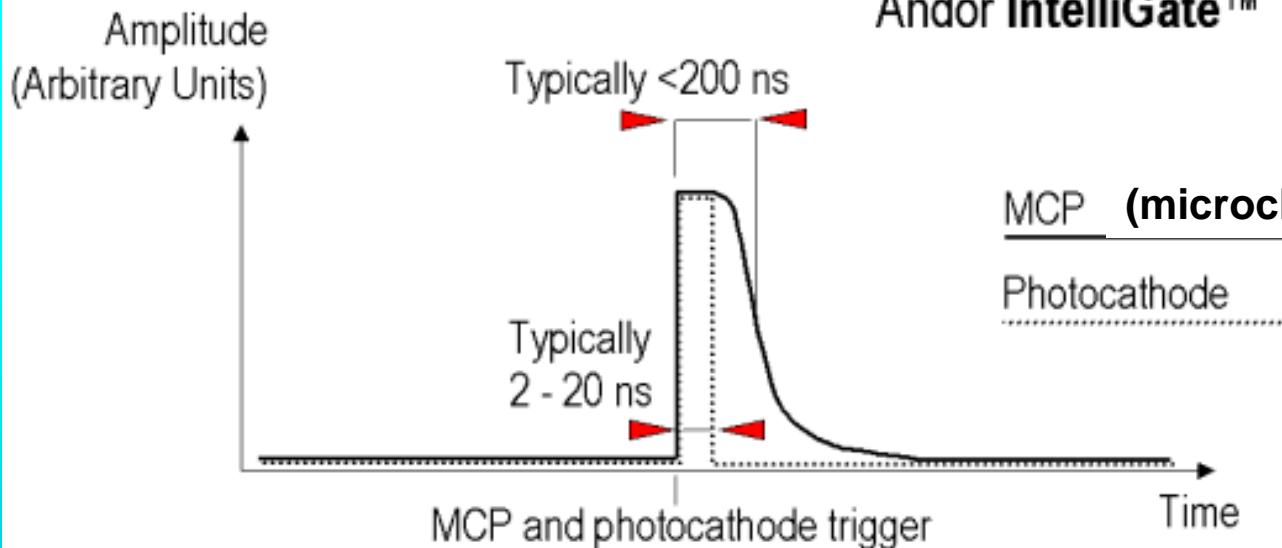
Intenzifikovaný CCD detektor (ICCD)

Jobin Yvon

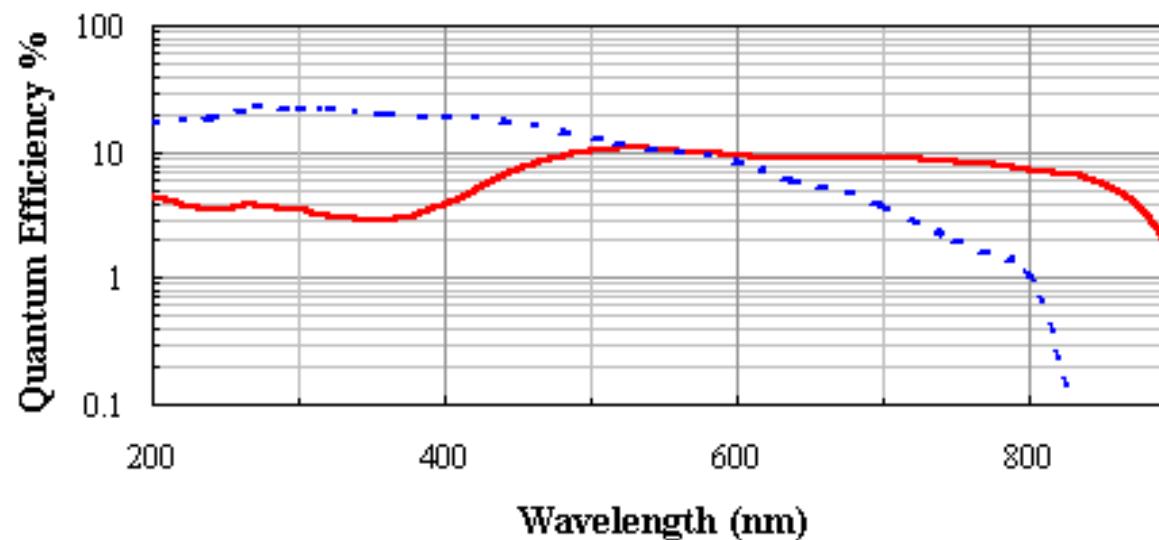


Andor

Andor IntelliGate™



QE of Intensifier Photocathodes



Aplikace

- rychlé snímání celých spekter
- měření v prostředí ochranné atmosféry (Ar, He) nebo přímo na vzduchu
- sondy s optickými vlákny – měření na nepřístupných místech (např. kontrola svářů pod vodou)
- lokální analýza (analýza nehomogenit)
- analýza ochranných povlaků a povrchově upravených materiálů (hloubkové profily)
- diagnostika při svařování, řezání a obrábění laserem

Aplikace

➤ analýzy na dálku (1-10 m) – taveniny, nepřístupná zařízení (části atomového reaktoru za olověným sklem)

➤ analýza kovových materiálů, keramických materiálů, skel, nerostných surovin

➤ single – shot režim (minimální narušení vzorku – výrobku či zařízení)

➤ analýza archeologických nálezů, uměleckých předmětů

➤ monitoring životního prostředí, výrobních procesů

➤ analýza a třídění odpadů

➤ analýza olejů a suspenzí

➤ analýza aerosolů

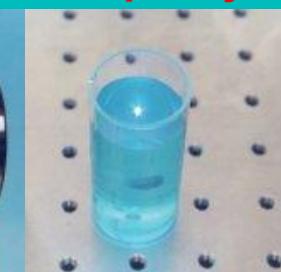
pevné vzorky



plyny



kapaliny

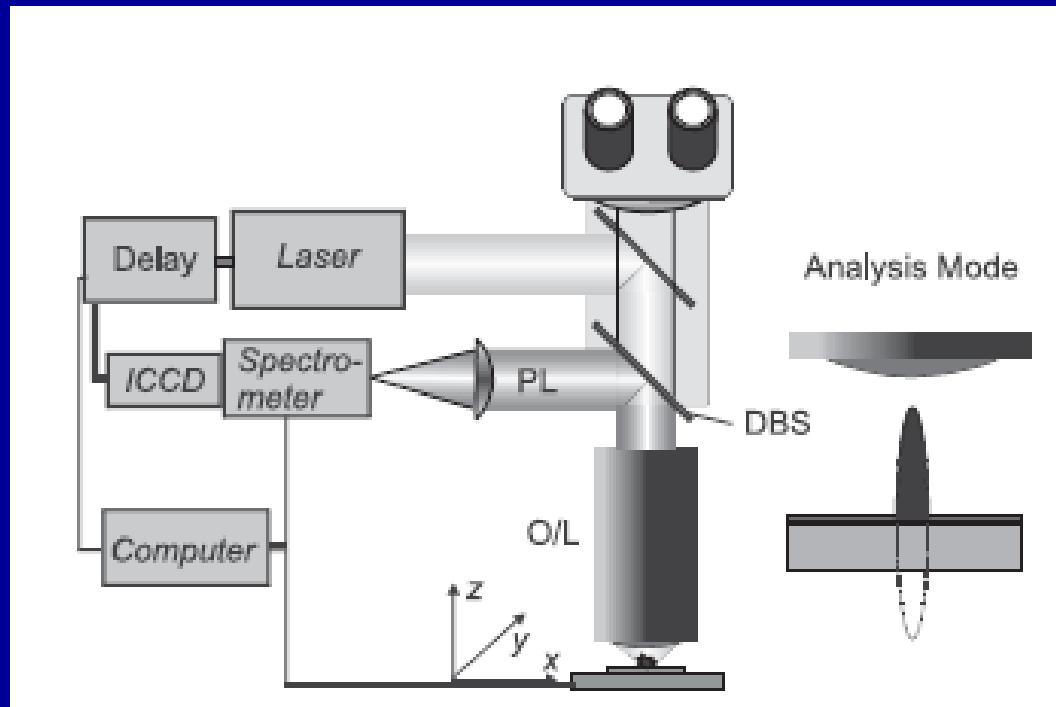


➤ nízké meze detekce (setiny procent až ppm)

➤ linearita kalibračních křivek (v závislosti na povaze vzorku a výběru emisní čáry)

Lokální analýza – mikroanalýza

- zařízení pro přesné zaměření laserového paprsku
- sledování tvaru kráterů a průběhu ablace CCD kamerou

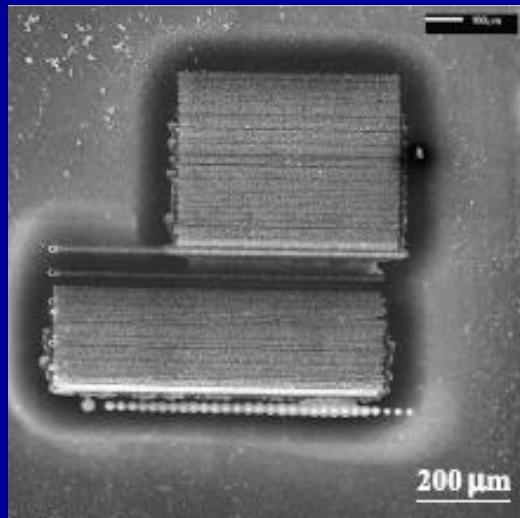


-s použitím vhodné optiky
velikost kráterů i pod 1 µm
(pod 100 µm běžně)

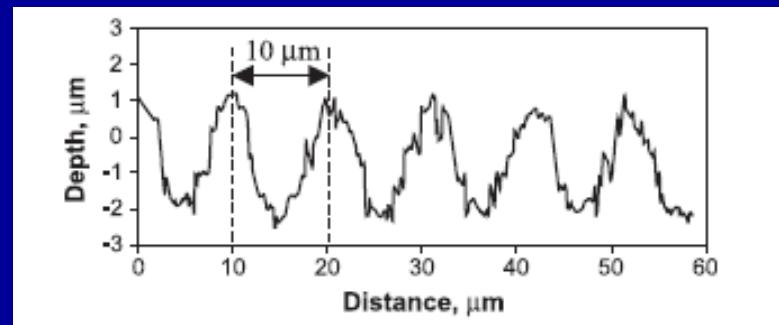
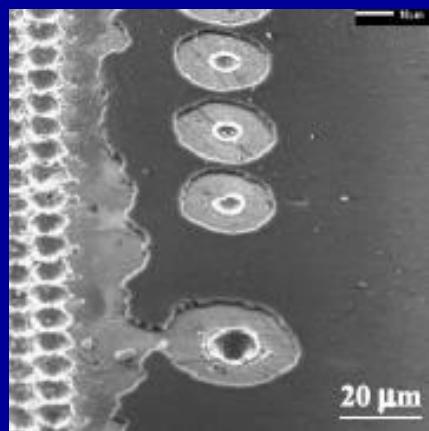
- geologické materiály
- nanotechnologie
- biologické materiály

Mapování povrchů

- zařízení pro přesné zaměření laserového paprsku
- sledování tvaru kráterů a průběhu ablace CCD kamerou
- automatizovaný posun vzorku - rastry

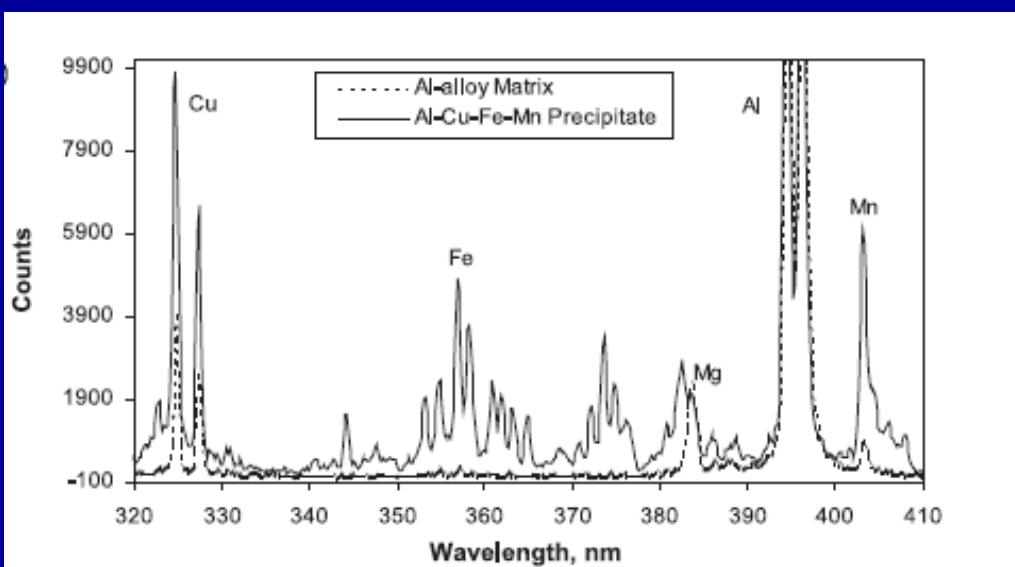


Mapování povrchu hliníkové slitiny



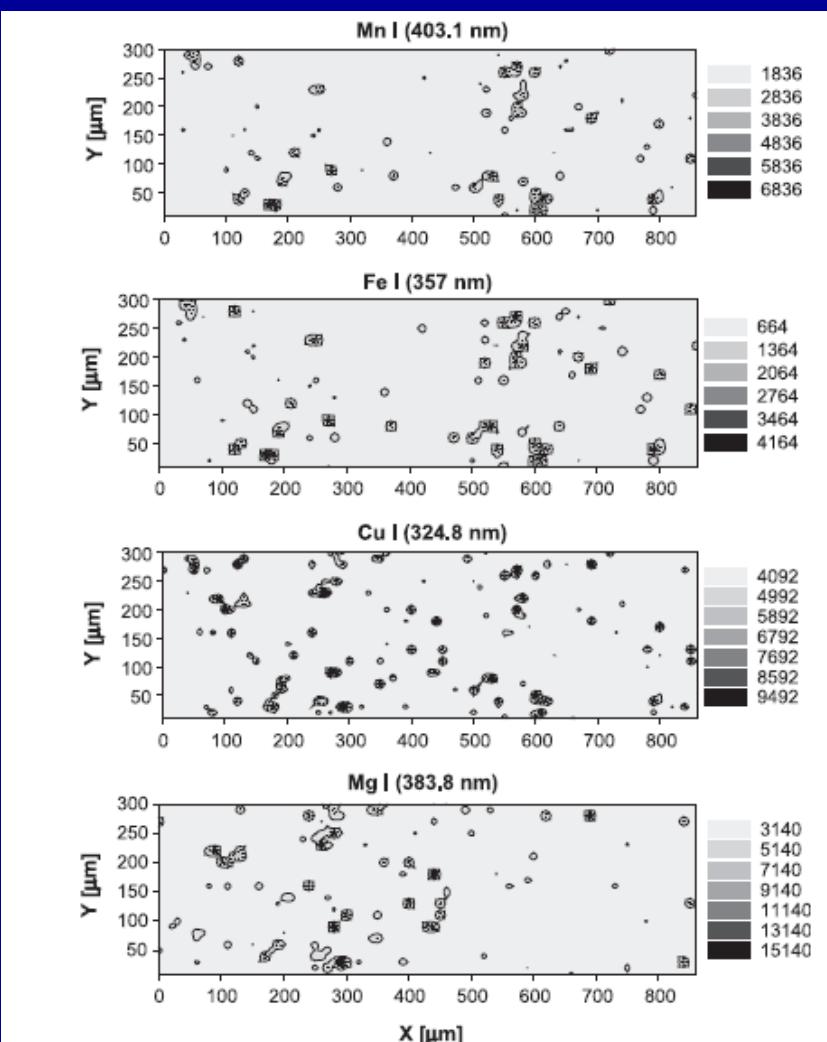
266 nm, 8 μJ

Mapování povrchů

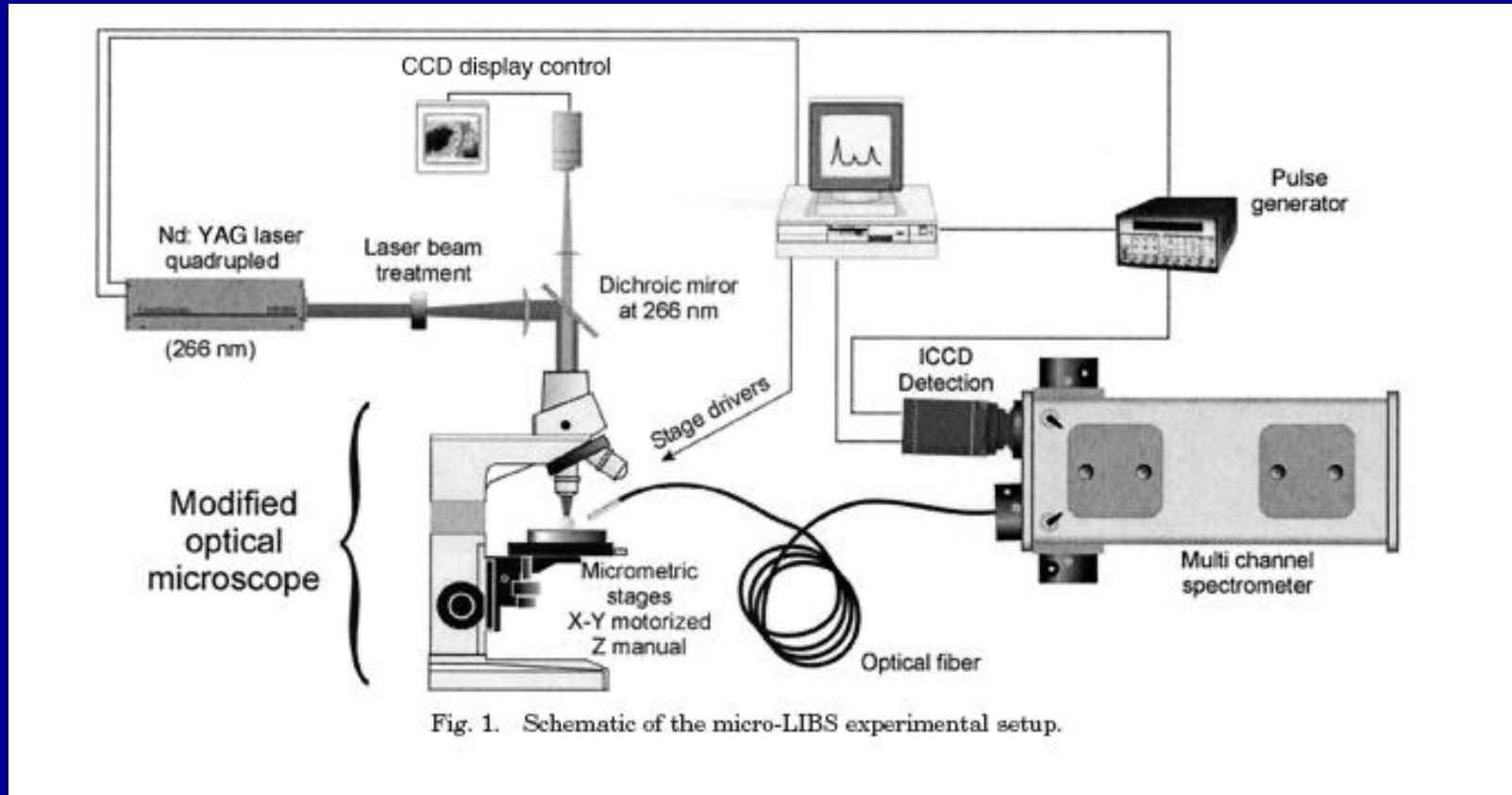


identifikovány 2 druhy precipitátů:
Al–Cu–Fe–Mn
Al–Cu–Mg

problém redepozice materiálu kolem
kráterů



Mapování povrchů



Micro-laser-induced breakdown spectroscopy technique: a powerful method for performing quantitative surface mapping on conductive and nonconductive samples

Denis Menut, Pascal Fichet, Jean-Luc Lacour, Annie Rivoallan, and Patrick Mauchien
20 October 2003 Vol. 42, No. 30 APPLIED OPTICS

Mapování povrchů

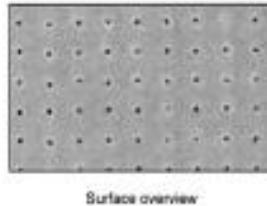
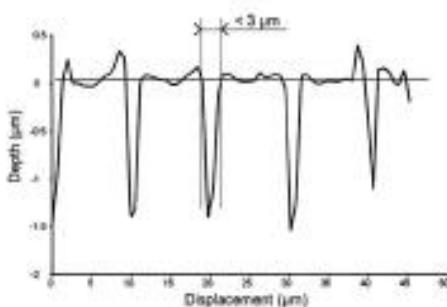


Fig. 3. Resolution of micro LIBS measured on a steel sample during a mapping test. The surface profile was obtained with the use of a light-phase microscopic interferometer.

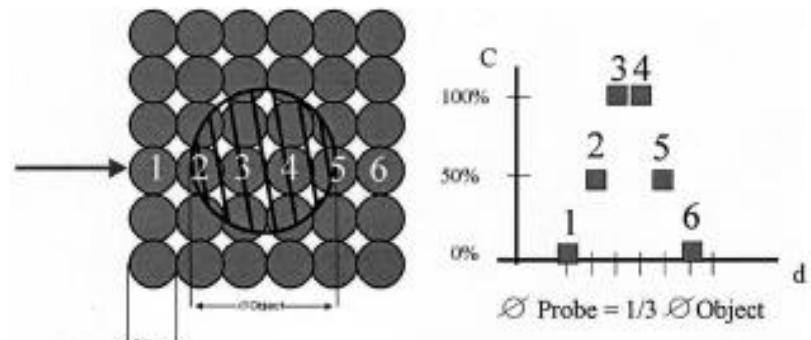


Fig. 4. Analytical resolution of a laser probe. At least four laser shots are required for the best concentration.

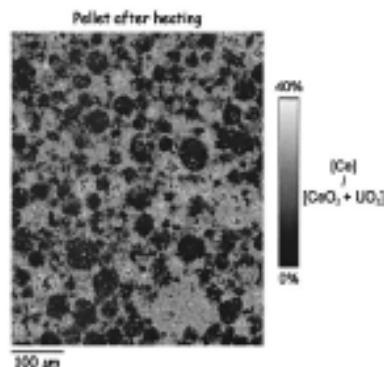
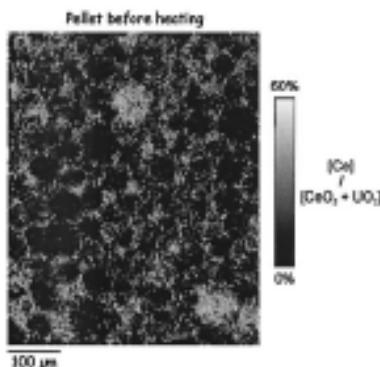


Fig. 5. Mapping of a ceramic pellet surface with 3- μm spatial resolution before and after heating of the pellet.

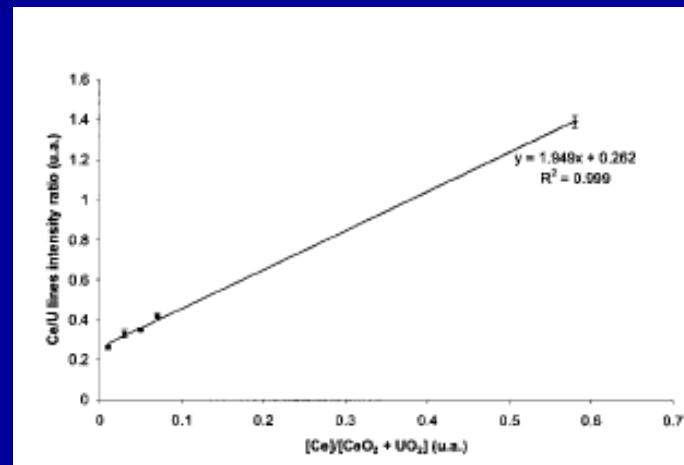


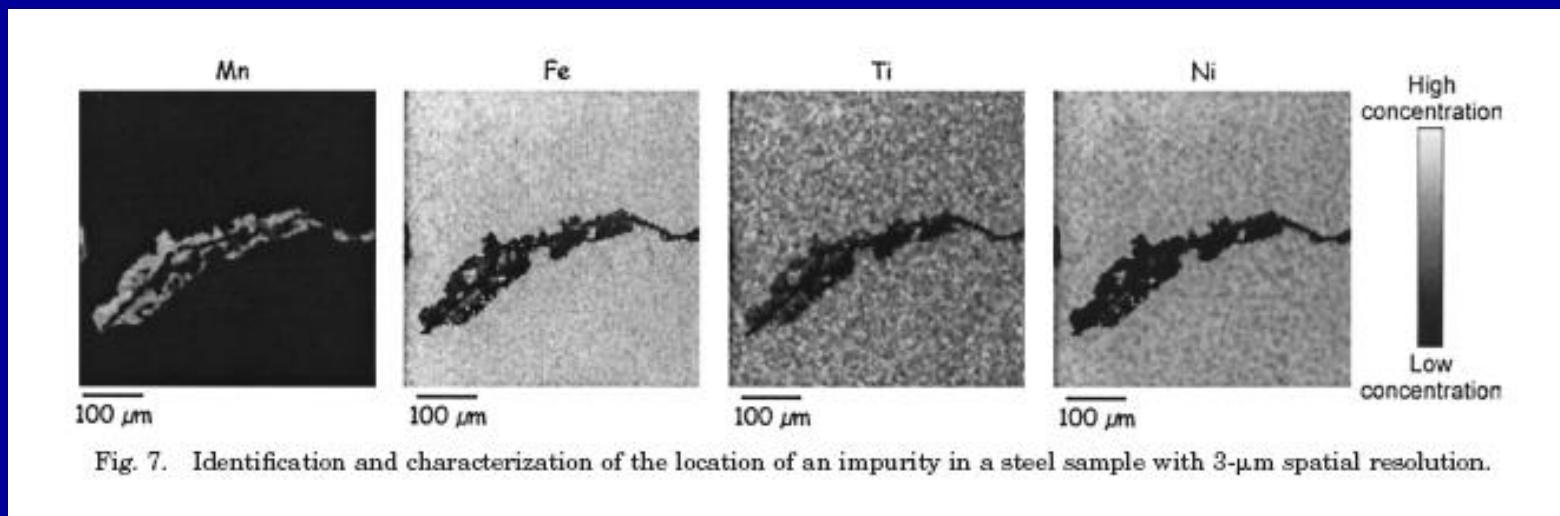
Fig. 6. Calibration of Ce in $[\text{CeO}_2, \text{UO}_2]$ pellets.

Mapování povrchů

stanovení nehomogenit v keramických materiálech

stanovení nehomogenit v kovech

prostorové rozložení prvků v geologických materiálech, půdách, popílcích

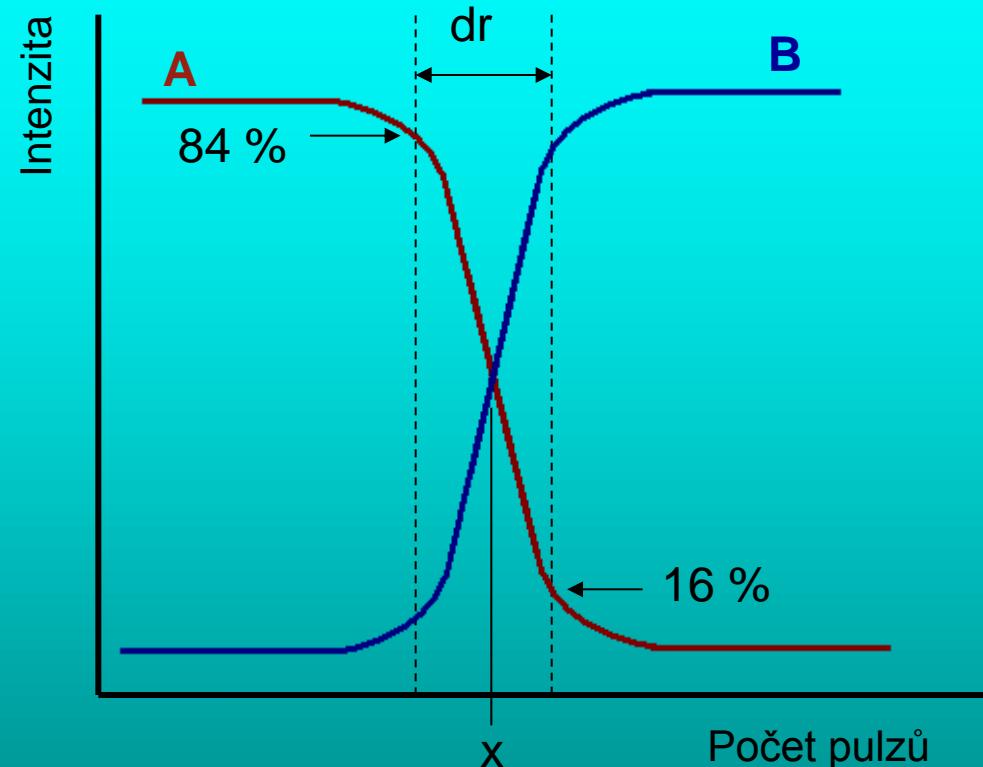


Stanovení hloubkového profilu

výhody jednoduchost, cena, minimální příprava vzorku, využití pro různé druhy vzorků, atmosférický tlak (další metody - GD-OES, LA-ICP-OES/MS, SIMS, EPXMA)

- vliv vlastností laserového paprsku na tvar kráteru a hloubkové rozlišení (vlnová délka, profil paprsku délka pulzu)
- široký rozsah - tloušťky vrstev (desítky nm až stovky μm)

Hloubkový profil



Průměrná ablační rychlosť (AAR)

$$AAR = \frac{\text{tloušťka vrstvy}}{\text{počet pulzů (x)}}$$

[nm/pulz]

Hloubkové rozlišení (DR) [μm]

$$DR = AAR * 10^{-3} * \text{počet pulzů (dr)}$$

Vzorky

Vzorek	Tloušťka Zn vrstvy [μm]	Obsah Zn [g. cm^{-2}]
Galfan	6	59
Galvanneal	9	59,1
Electroplated Zn	10	71,1
Hot dipped Zn	20	131,3
Aluzink	24	36,9

Krátery

100

200

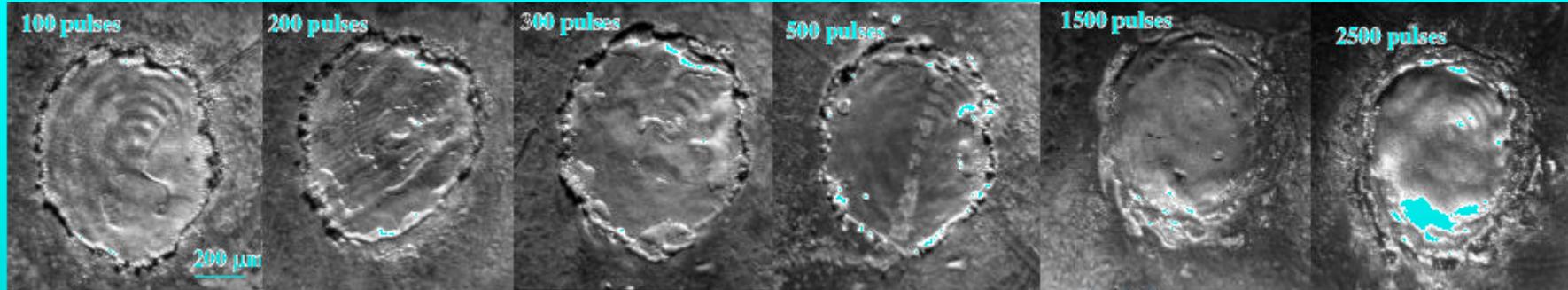
300

500

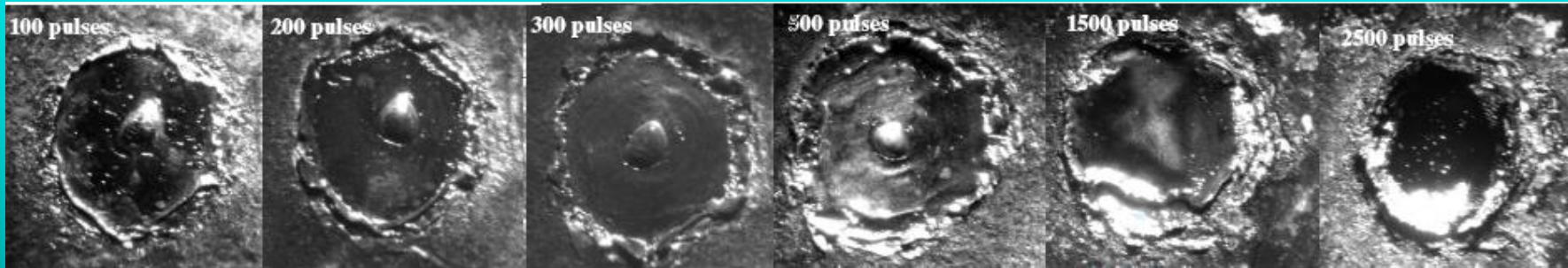
1500

2500

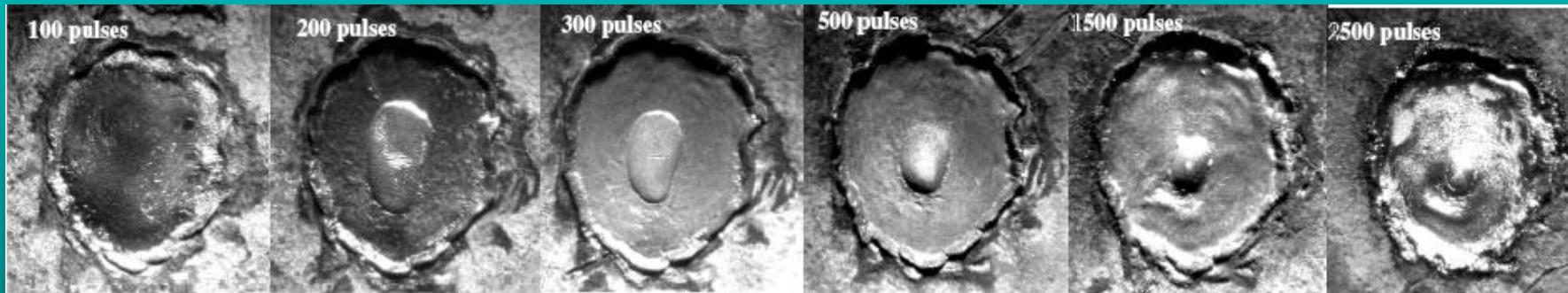
Helium



Argon



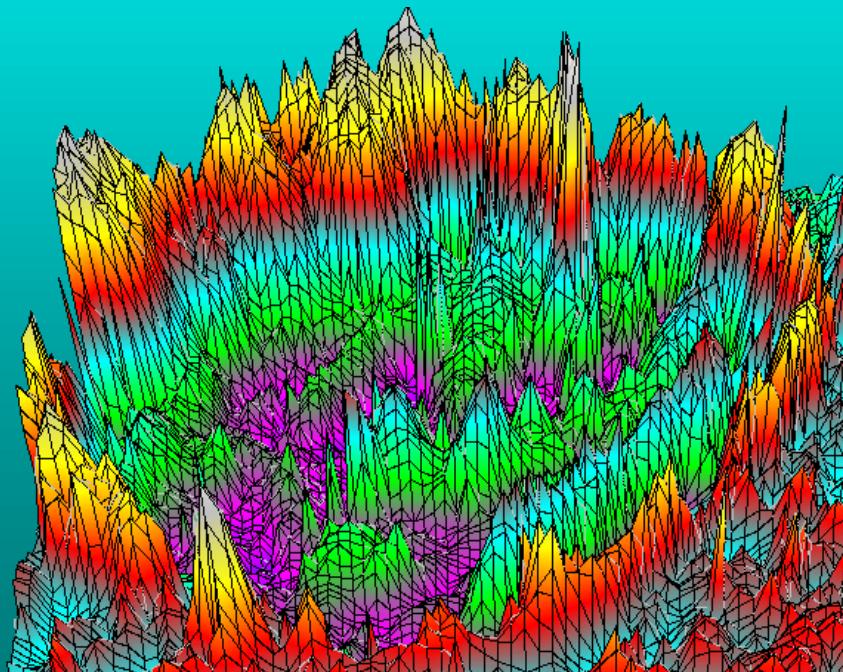
Vzduch



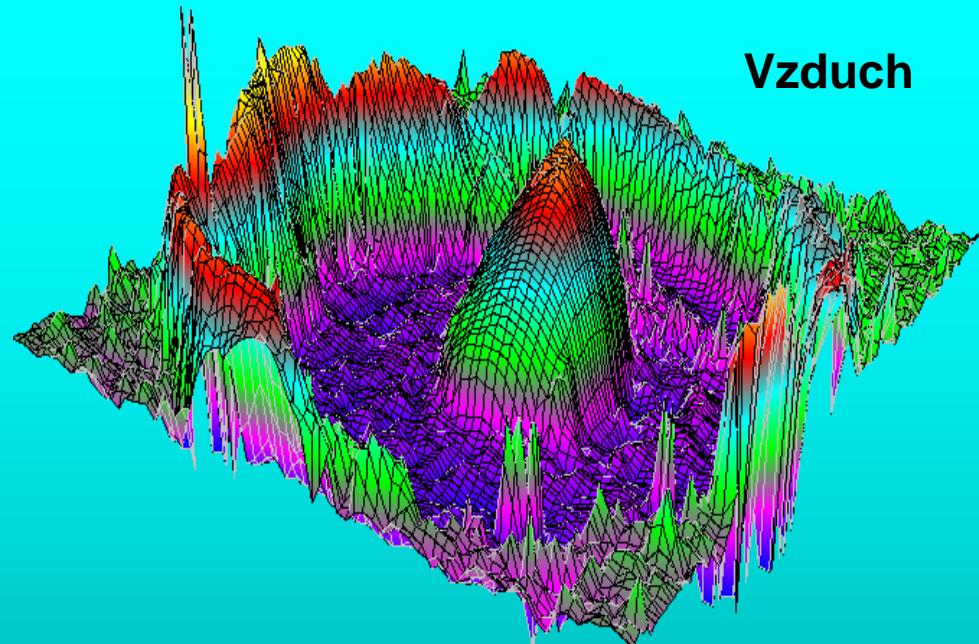
Electroplated Zn – Sollac, Zn (I) 280,08 nm, Fe (I) 344,06 nm, 100 mJ/pulz,
He -20 mm, Ar -15 mm, vzduch -20 mm.

**3D profily ablačních kráterů
po dopadu 200 laserových
pulzů o energii 100 mJ**

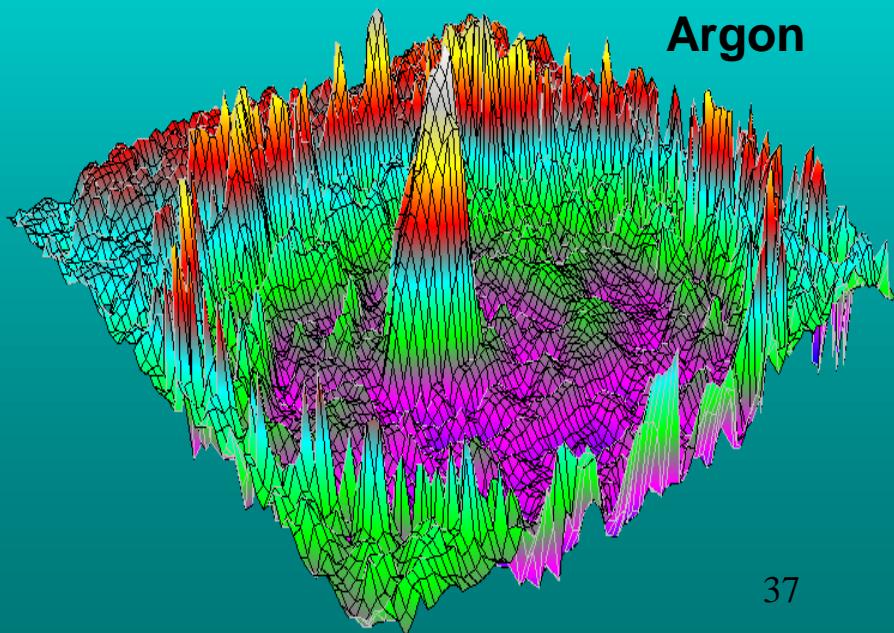
Helium



Vzduch



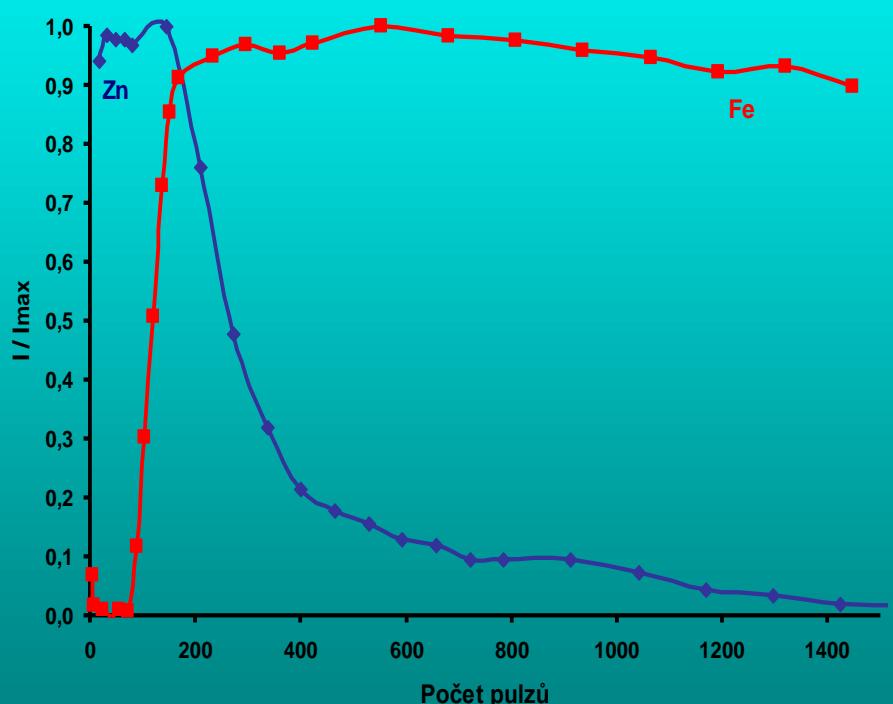
Argon



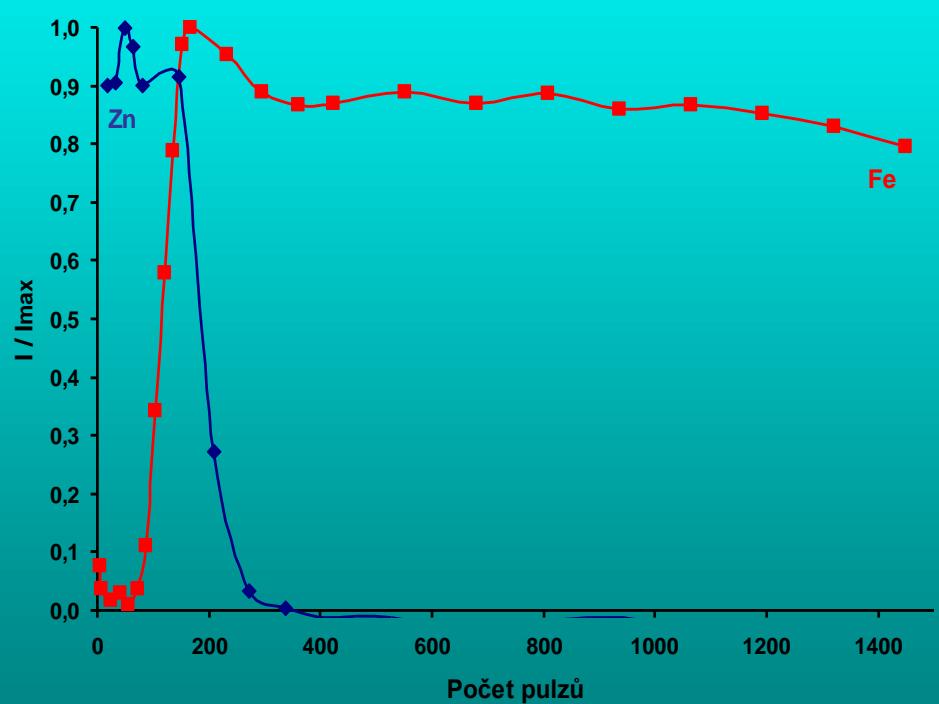
Vliv časové prodlevy

Helium

5 μ s

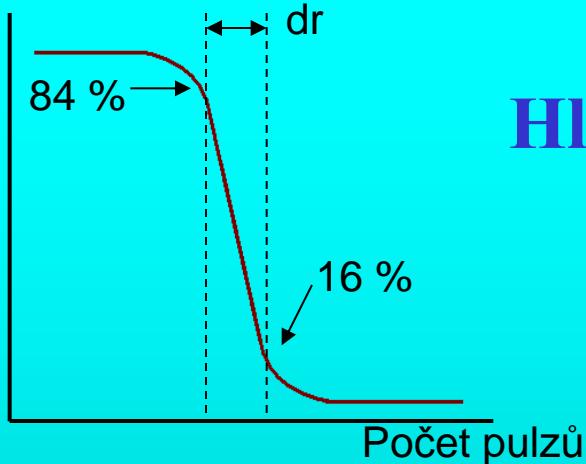


10 μ s



Electroplated Zn – Sollac, Zn (I) 280,08 nm, Fe (I) 344,06 nm, 100 mJ/pulz, He -20 mm.

Intenzita



Hloubkové rozlišení

$$DR = AAR * dr$$

Helium (100 mJ/pulz)

Vzorek	Tloušťka vrstvy Zn [μm]	DR Fe [μm]		DR Zn [μm]	
		5	10	5	10
Galfan	6	2	2	28	9
Galvanneal	9	~	~	23	15
Electroplated Zn	10	4	3	19	5
Hot Dipped Zn	20	12	7	25	13
Aluzink	24	15	10	28	14

Stanovení prostorového rozložení prvků ve vzorcích

3 D mapování

- kombinace mapování povrchu a stanovení hloubkového profilu
- vliv vlastností laserového paprsku na tvar kráteru, hloubkové a prostorové rozlišení (vlnová délka, profil paprsku délka pulzu)
- aplikace na vrstevnaté materiály (keramické dlaždice)
- zatím nepříliš rozšířená technika (postery na konferencích)

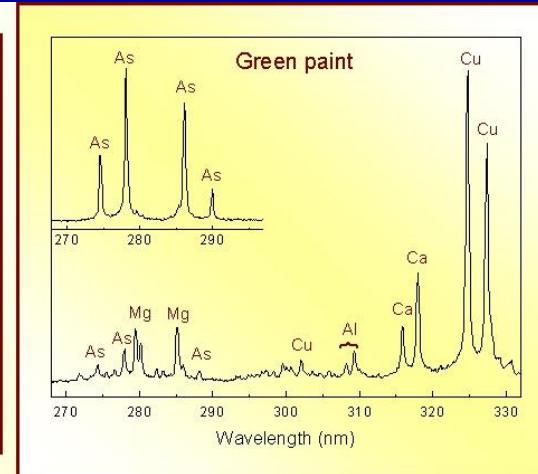
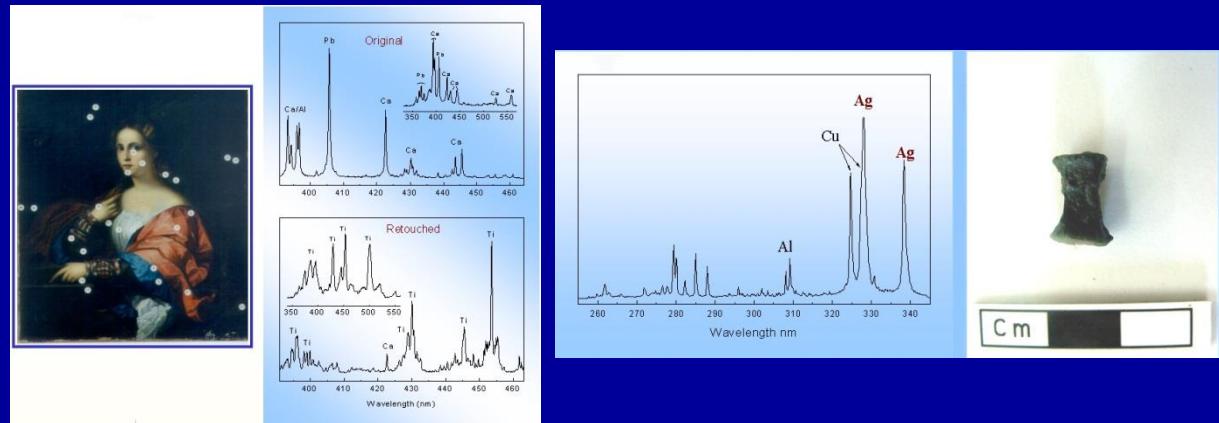
Analýza uměleckých předmětů

Hellenic Project for Wider Application (Řecko)

množství materiálu 20-200 ng

hloubka kráteru 1-20 µm

průměr kráteru < 100 µm



Analýza uměleckých předmětů



Analýza uměleckých předmětů

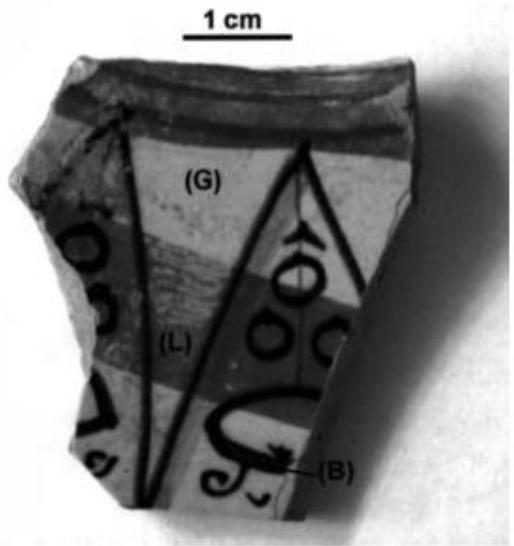


Fig. 1. Ceramic sample D29—areas analyzed by LIBS are signed with (G)—glaze, (B)—blue pigment, (L)—golden luster.



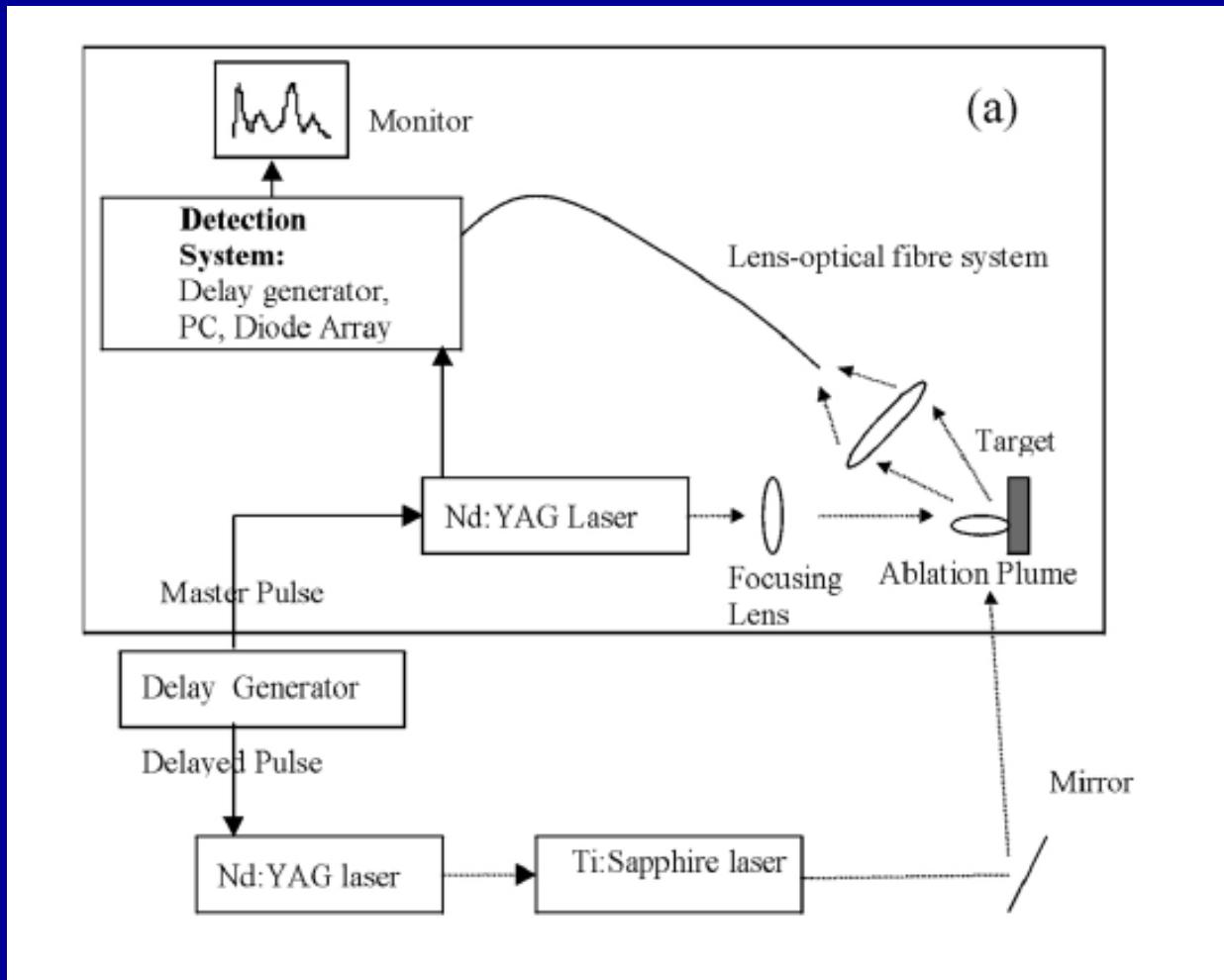
Fig. 2. Fragment of Roman sculpture: the areas analyzed by LIBS are shown by arrows.

Table 2
Description of bronze samples analyzed

Sample	Description	Dated
Finger	Fragment of Roman sculpture	I Century BC
MN16	Coin with head of Marco Aurelio, weight 8 g.	AC 140
MN9	Coin with head of Nerone, weight 3.3 g.	AC 54
MN40	Coin of 5 centesimal, with head of Vittorio Emmanuele II, weight 4.5 g.	AC 1862

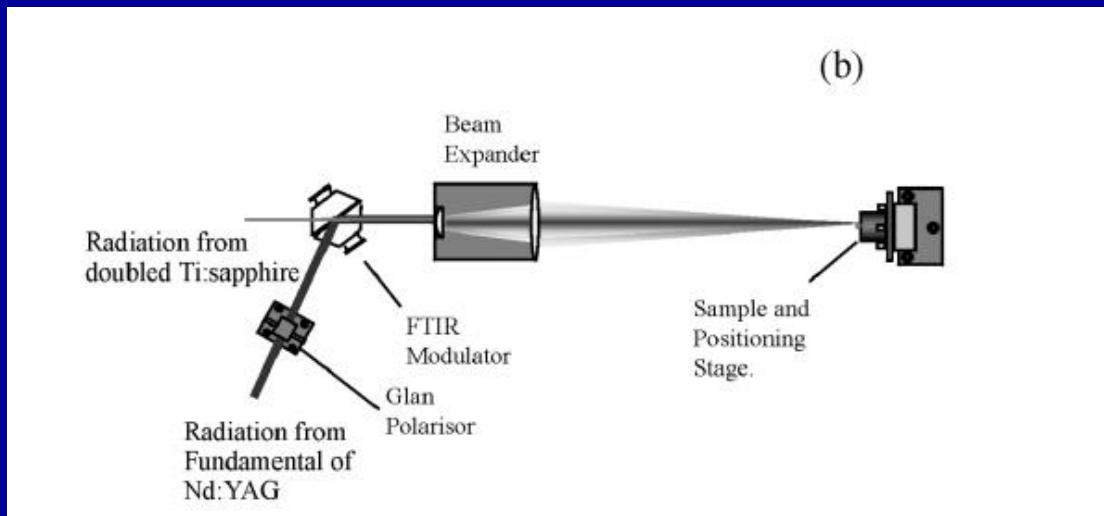
Kombinace LIBS a LIFS

➤ zvýšení citlivosti a selektivity metody



Sensitive and selective spectrochemical analysis of metallic samples: the combination of laser-induced breakdown spectroscopy and laser-induced fluorescence spectroscopy: H.H. Telle,, D.C.S. Beddows, G.W. Morris, O. Samek
Spectrochimica Acta Part B 56 (2001) 947-960

Kombinace LIBS a LIFS



mezí detekce ~ 1 ppm

v kovových materiálech

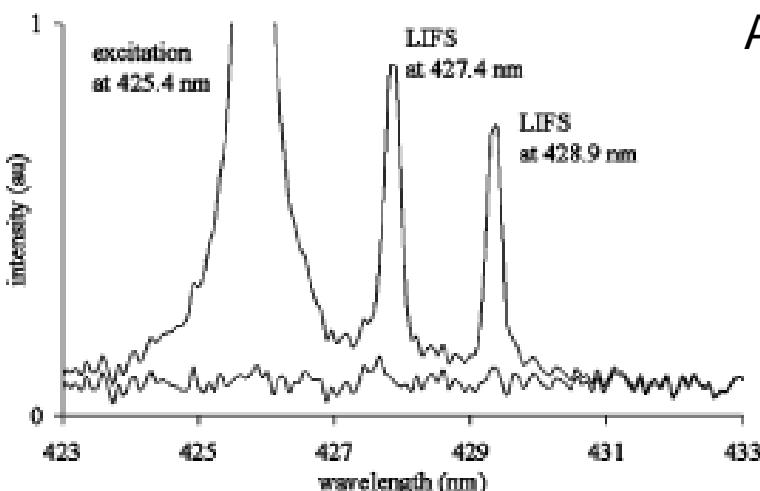
Table 1

Experimental parameters for LIFS for elements investigated in this study. Relevant spectral data are included

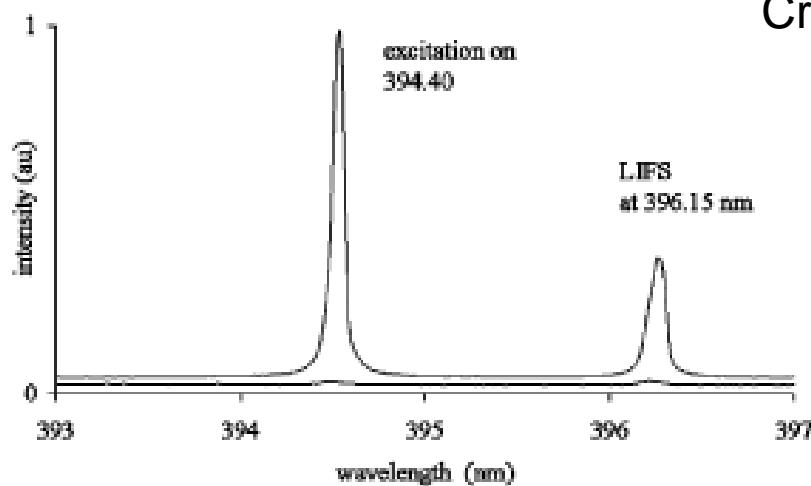
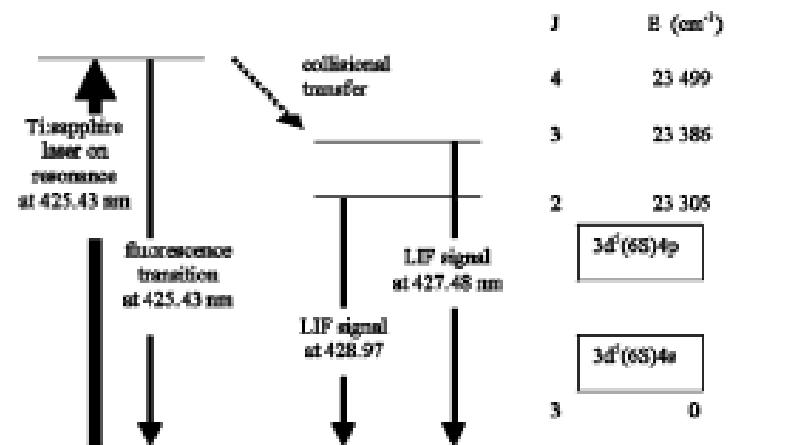
Element	Probe wavelength (nm)	Observation wavelength (nm)	τ (ns)	Experimental set-up	Pulse energies	
					Probe (mJ)	Ablation (mJ)
Al	394.40 (2ω)	396.15	10	L; F	4	20
Cr	425.40 (2ω)	427.48	33	L; F; M	2	15
		428.97	31			
Fe	425.08 (2ω)	432.58	20	L; F; M	4	20
		430.79	29			
Si	251.61 (3ω)	288.16	5.3	L; F	1	20

Abbreviations: L, laboratory set-up; F, remote fibre set-up; M, remote FTIR modulator set-up. Values for the radiative lifetimes τ were obtained from Lide [15].

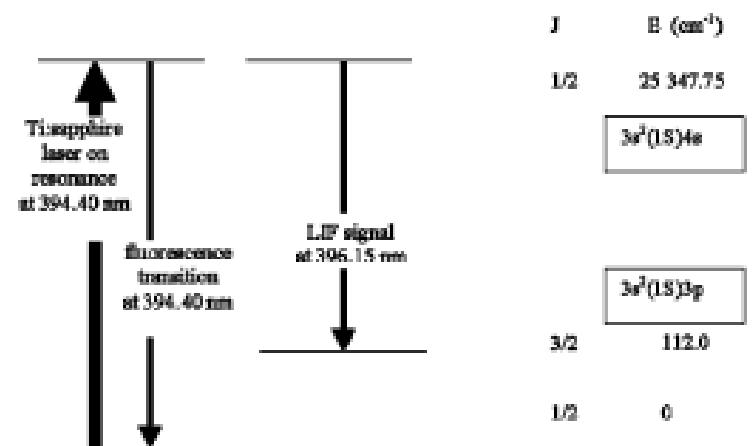
Kombinace LIBS a LIFS



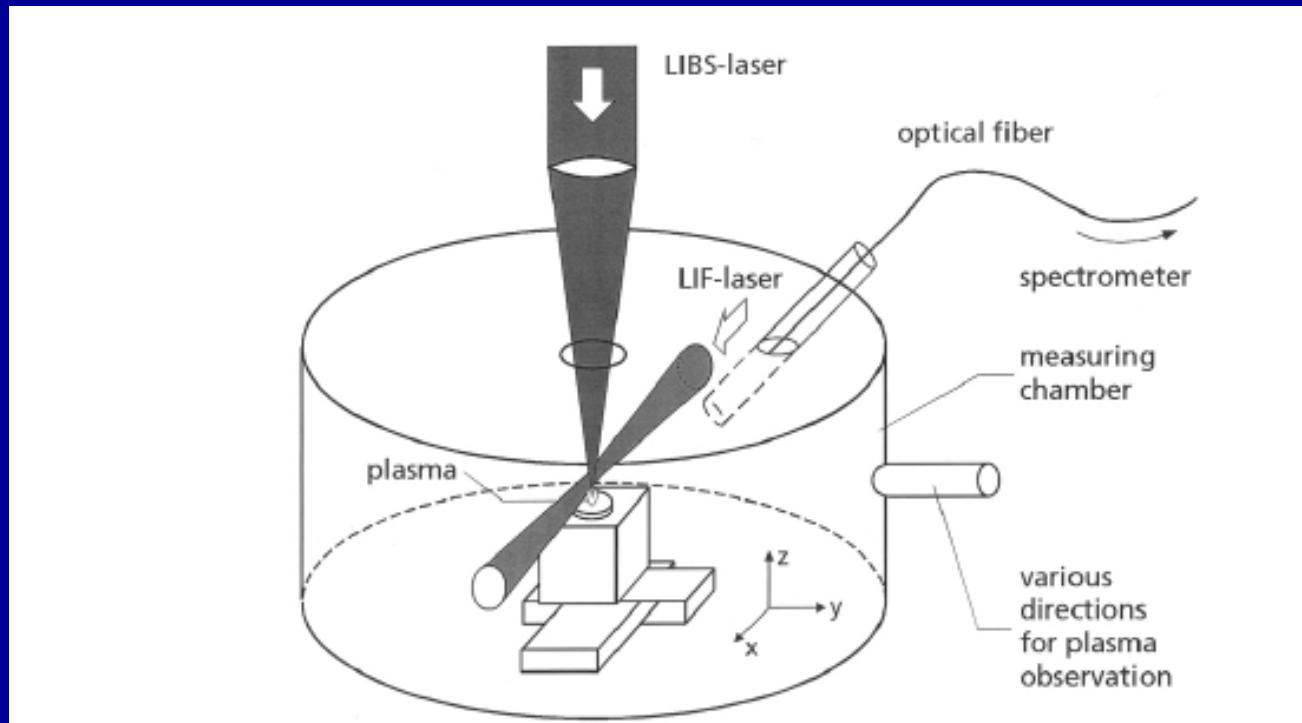
Al



Cr



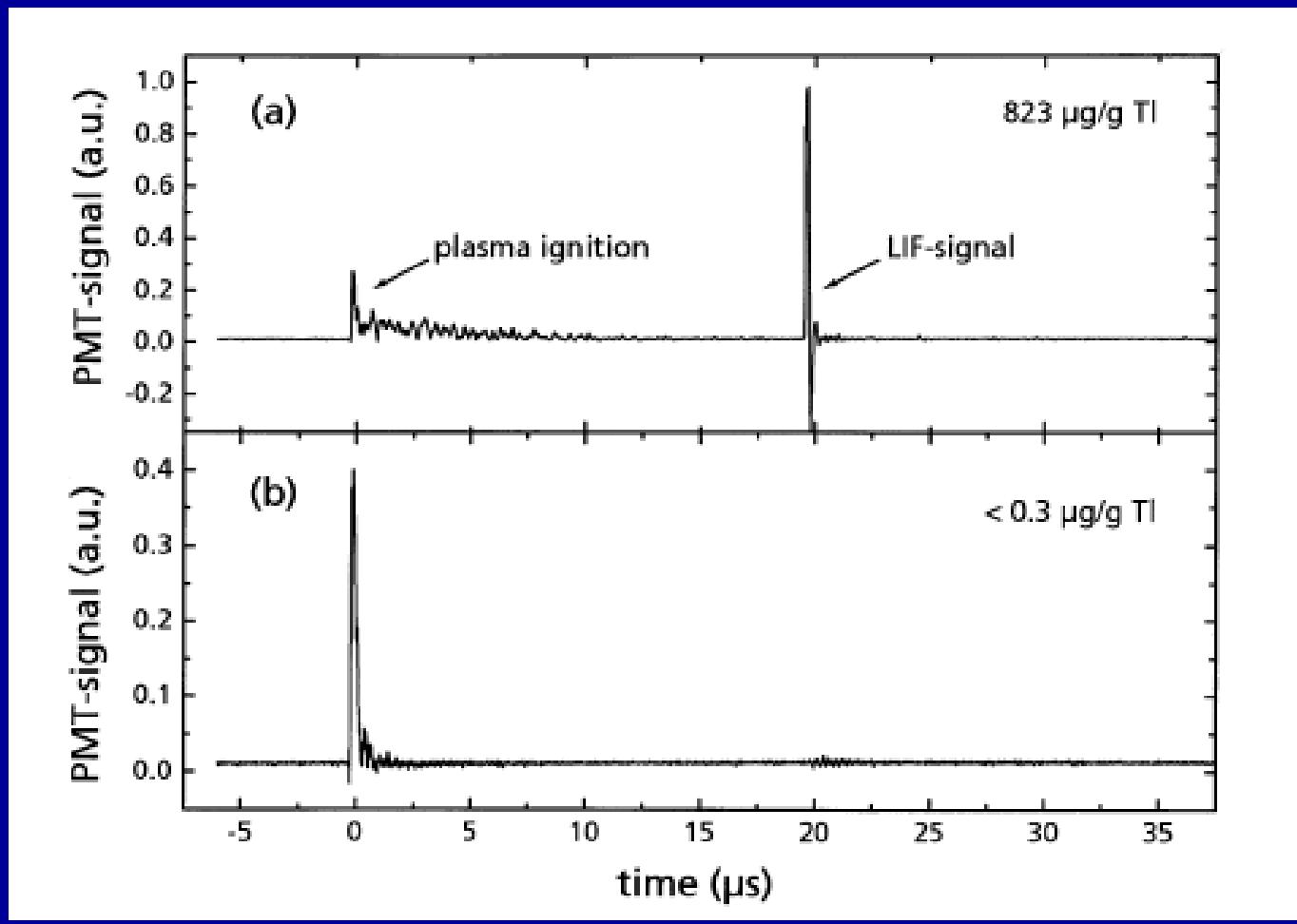
Kombinace LIBS a LIFS



Analysis of heavy metals in soils using laser-induced breakdown spectrometry combined with laser-induced fluorescence

Frank Hilbk-Kortenbruck,, Reinhard Noll, Peter Wintjens, Heinz Falk, Christoph Becker
Spectrochimica Acta Part B 56 (2001) 933-945

Kombinace LIBS a LIFS



Kombinace LIBS a LIFS

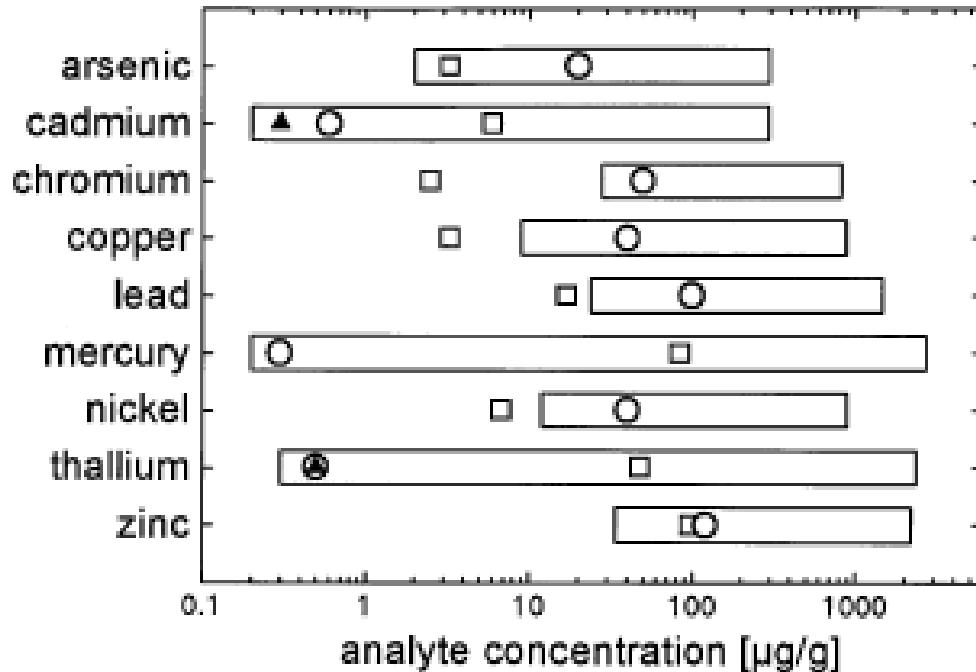
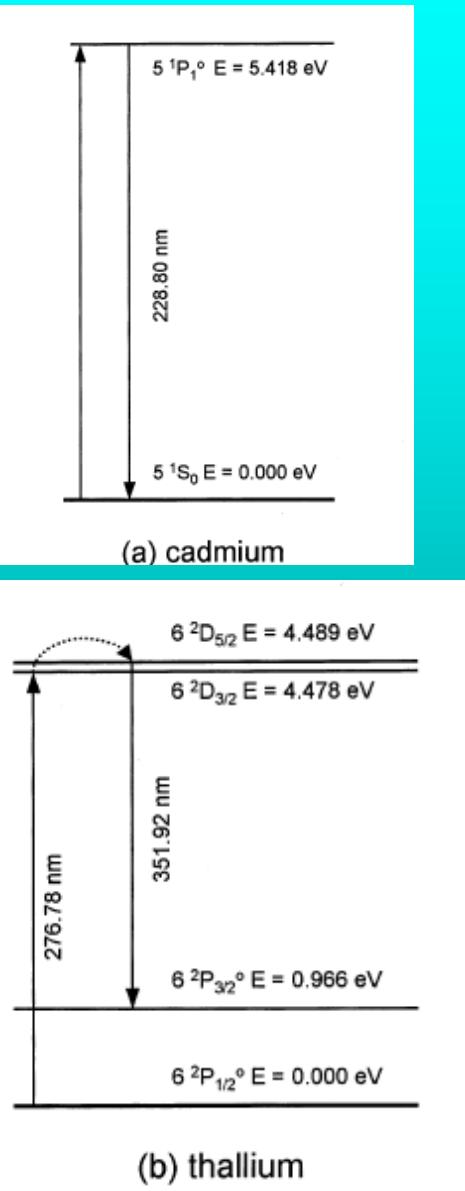
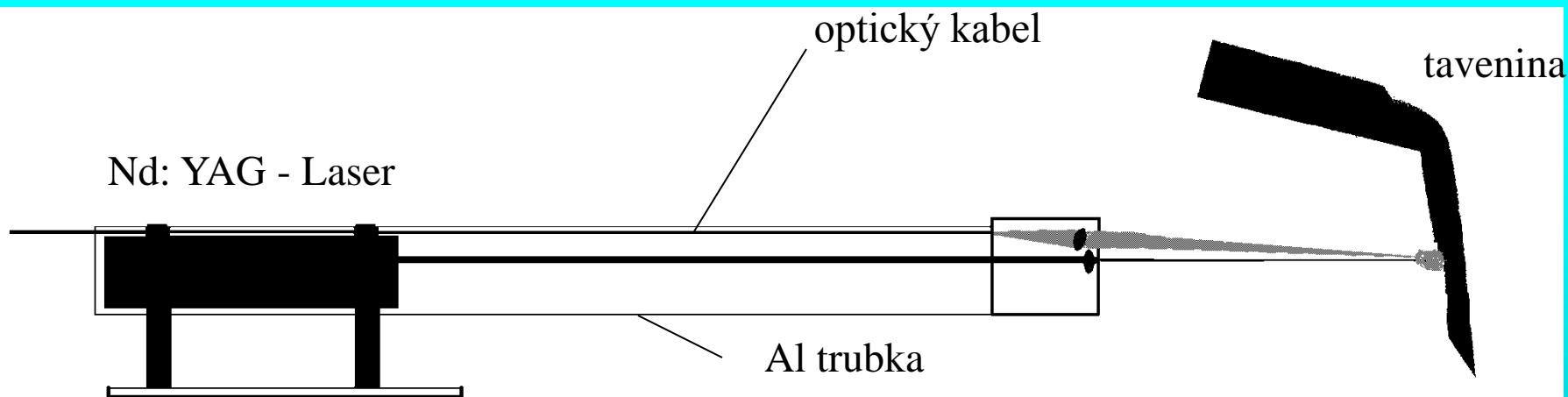


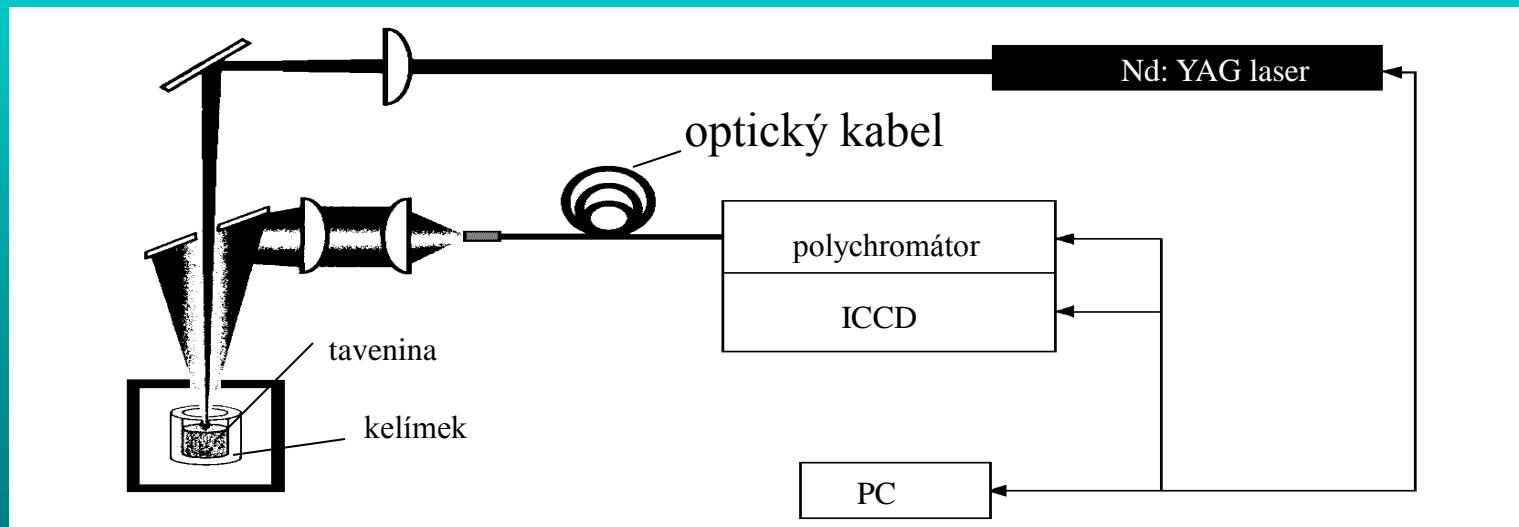
Fig. 7. Illustration of the detection limits ($\text{LOD}_{3\sigma}$) demonstrated with LIBS (□) and LIBS-LIF (▲) for the analysis of soils at atmospheric pressure in comparison with German regulatory limits for unpolluted soils (Z0, ○). The bars depict the range of analyte concentrations covered by the calibration samples.



Uspořádání pro měření tavenin



U. Panne, R. E. Neuhauser, C. Haisch, Remote Analysis of a Mineral Melt by Laser – Induced Plasma Spectroscopy, Appl. Spectrosc. (2002) 56, (3) 375



J. Yun, R. Klenze, J. Kim, Laser-Induced Breakdown Spectroscopy for the On-Line Multielement Analysis of Highly Radioactive Glass Melt, Appl. Spectrosc. (2002) 56, (4) 437

Spectrolaser 1000HR

Hloubka: 38cm
Délka: 72cm
Výška: 30cm
Váha: 25kg
Laser: Nd:YAG 1064nm

Optika: 4 Czerny-Turner Spektrografy
Detektory: 4 CCD (simultánní režim)
Rozsah: 180 - 930nm
Rozlišení: ~ 0.15nm
Doba Analýzy: 20 s



PharmaLIBS™ 250

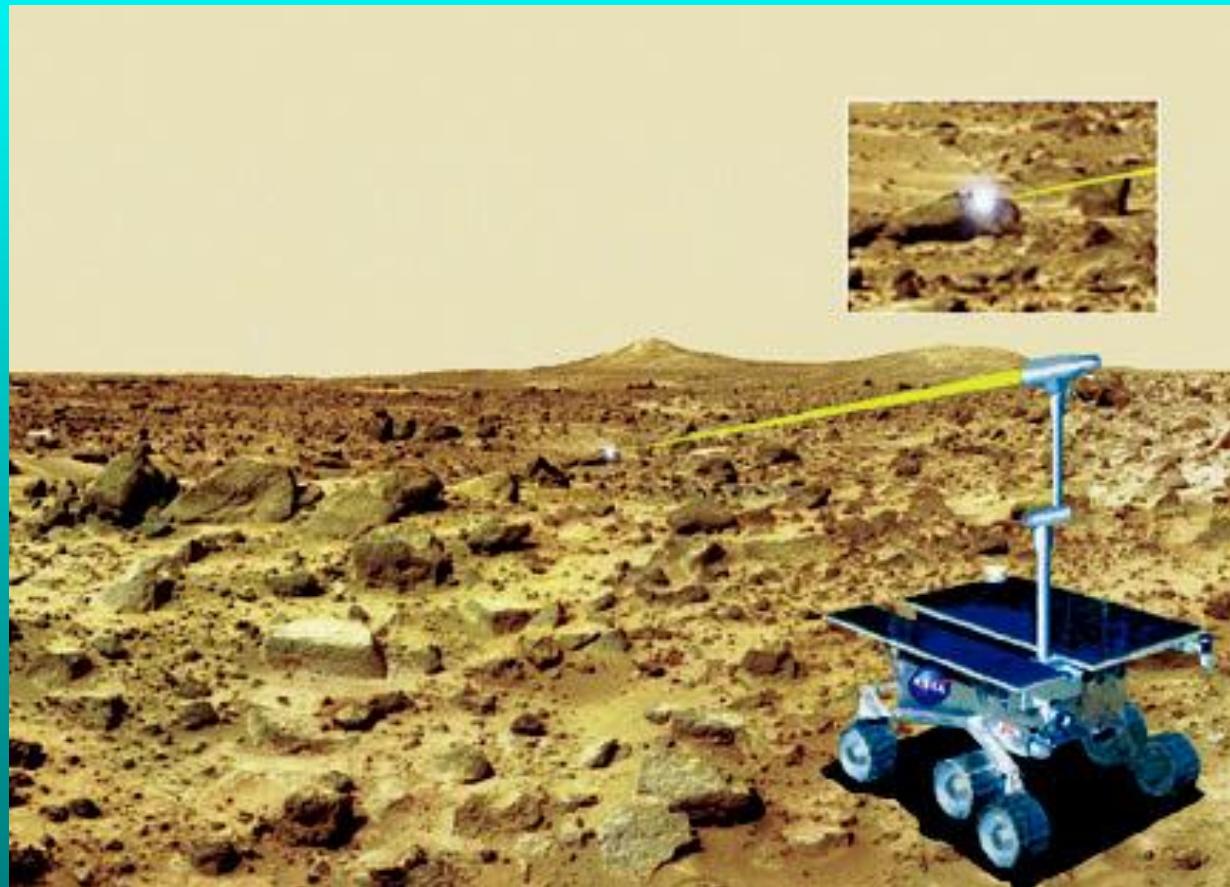


Los Alamos National Laboratory

kontrola nožů na bobech: Zimní Olympijské Hry v Salt Lake City 2002



NASA - vývoj marsovského vozítka vybaveného LIBS analyzátorem



V současné době aktuální a rozvíjející se technika:

pokrok ve vývoji laserů (spolehlivost, cena, velikost)

relativně jednoduchá instrumentace (kompaktní přenosná zařízení)

in-situ a on-line monitoring (sondy s optickými vlákny)

měření „na dálku“ (remote monitoring)

aplikace na širokou škálu materiálů – průmysl, životní prostředí, medicína ...

vývoj komerčních přístrojů

výzkum a vývoj nových metod stanovení

Mezinárodní konference	LIBS 2000 (Pisa, Itálie)
	EMSLIBS 2001 (Káhira, Egypt)
	LIBS 2002 (Orlando, USA)
	EMSLIBS 2003 (Hersonissos, Kréta)
	LIBS 2004 (Malaga, Španělsko)
	EMSLIBS 2005 (Aachen, Německo)
	LIBS 2006 (Montreal, Kanada)
	EMSLIBS 2007 (Paris, Francie)
	LIBS 2008 (Berlin, Německo)
	EMSLIBS 2009 (Tivoli Terme, Řím, Itálie)
	LIBS 2010 (Memphis, Tennessee, USA)
	EMSLIBS 2011 (Izmir, Turecko)
	LIBS 2012 (Káhira, Egypt)
	EMSLIBS 2013 (Bari, Itálie)
	LIBS 2014 (Peking, Čína)